

บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย

2.1 การเตรียมสารตัวอย่าง (sample preparation)

สารที่ได้เตรียมเป็นสาร 4 ชนิด ด้วยกัน มีหลายสูตรดังแสดงที่ข้างล่าง

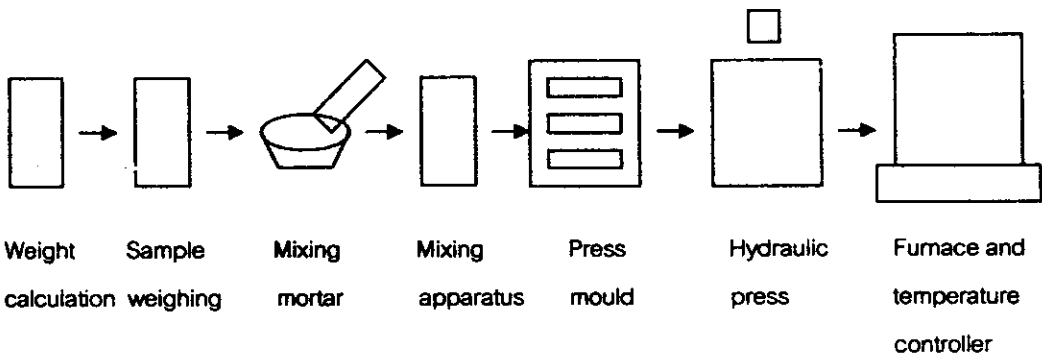
สารให้ความร้อน : $ZnO+0.01Nb_2O_5$, $ZnO+0.02TiO_2$

เทอร์มิสเตอร์แบบ NTC : $NiMn_2O_4$, $Fe_2O_3+Nb_2O_5$, $SnO_2+Fe_2O_3$, $MgFe_2O_4+Fe_2O_3$, $Mn_{0.2}Ni_{0.8}Fe_2O_4$, $LaCoO_3$

เทอร์มิสเตอร์แบบ PTC : $BaTiO_3+0.9ZrO_2$, $BaTiO_3+0.01Nb_2O_5$, $BaTiO_3+0.05Nb_2O_5$, $BaTiO_3+0.1Nb_2O_5$,
 $(Sr_{0.5}Pb_{0.5})TiO_3$, $Pb(Zr_{0.4}Ti_{0.3}Y_{0.3})O_3$, $(Ba_{0.5}Pb_{0.5})TiO_3$, $Ba(Ti_{0.8}Sn_{0.2})O_3$, $Bi_2O_3+Fe_2O_3$,
 ZrO_2+MnO_2 , SnO_2+2CoO , $SnO_2+Cr_2O_3$

ตัวเก็บประจุ : $BaTiO_3+0.1SrCO_3$, $BaTiO_3+0.9ZrO_2$, $BaTiO_3+0.01Dy_2O_3$, $BaTiO_3+0.01Nb_2O_5$,
 $BaTiO_3+0.05Nb_2O_5$, $BaTiO_3+0.1Nb_2O_5$, $(Sr_{0.5}Pb_{0.5})TiO_3$, $Pb(Zr_{0.4}Ti_{0.3}Y_{0.3})O_3$,
 $(Ba_{0.5}Pb_{0.5})TiO_3$ และ $Ba(Ti_{0.8}Sn_{0.2})O_3$, $(Ba_{0.9}La_{0.1})TiO_3$, $(Ba_{0.5}Zn_{0.5})TiO_3$

ขอยกตัวอย่างวิธีการเตรียมสาร $ZnO+0.01Nb_2O_5$ โดยวิธีเทคนิคเซรามิกมาตรฐาน (standard ceramic techniques) เริ่มจากผง ZnO ที่มีความบริสุทธิ์ 99 % และ Nb_2O_5 ที่มีความบริสุทธิ์ 99.9 % คำนวณน้ำหนัก ซึ่งผงของสารด้วยเครื่องชั่ง ผสมสารด้วยโถรง นำผงของสารใส่กระป๋องพลาสติก หมุนผสมสารด้วยเครื่องหมุน หยดโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ผสมน้ำกลั่น นำผงของสารใส่เข้าชั้ด นำเข้าชั้ดติดตั้งที่เครื่องชั้ดสาร (RIIK 25 tons) ชั้ดเป็นก้อน วางไว้วันหนึ่งแล้วนำก้อนสารวางในเตาหลอม (furnace) ที่ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (FCR-13A-R/M) และใช้เทอร์โมคอปเปิลชนิด K (CA) (model JB-35) เมาที่ $1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ตามลำดับ ใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ $5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ และอุณหภูมิขึ้นไฟ 1 h ขั้นตอนการเตรียมสารแสดงในรูปที่ 2.1

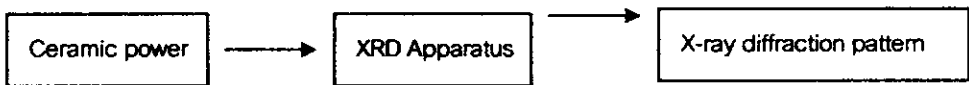


รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการเตรียมก้อนสาร

ส่วนการเตรียมสารอื่นๆจะใช้วิธีการทำนองเดียวกัน สารต่างสูตรกันจะใช้อุณหภูมิการเผาที่แตกต่างกัน แต่ใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิของเตาหลอมเท่ากัน กรณีที่สารที่ผ่านการเผาครั้งที่ 1 มีความเปราะก็จะนำไปบดเป็นผง ชั้ดเป็นก้อนและเผาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อุณหภูมิการเผาของสารสูตรต่างๆแสดงข้างล่างนี้

2.2 การตรวจสอบเฟส การวัดขนาดและการทำซ้ำไฟฟ้า

นำก้อนสารที่ผ่านการเผาไปถ่ายด้วยเครื่อง XRD (X-ray diffractometer) (Philips PW3710) เพื่อดูเฟส (phase) ของสาร แอนโตนของหลอดทำมาจาก Cu ความต่างศักย์ไฟฟ้า 40 kV กระแสในหลอดรังสีเอกซ์ 35 mA มุมแบรกก์ที่ทำการถ่าย 2 θ อยู่ในช่วง 15.004° ถึง 84.995° และความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ที่ใช้ (λ_{Cu}) เป็น 1.54060 Å การจัดเครื่องมือเพื่อตรวจสอบเฟสของสารด้วยเครื่อง XRD แสดงดังรูปที่ 2.2 วัดความหนาและเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยไมโครมิเตอร์ ทำซ้ำด้วยการเงินซึ่งทำได้โดยผสมเงินกับกาว ทาบนผิวของสารแล้วอบด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 10 นาที



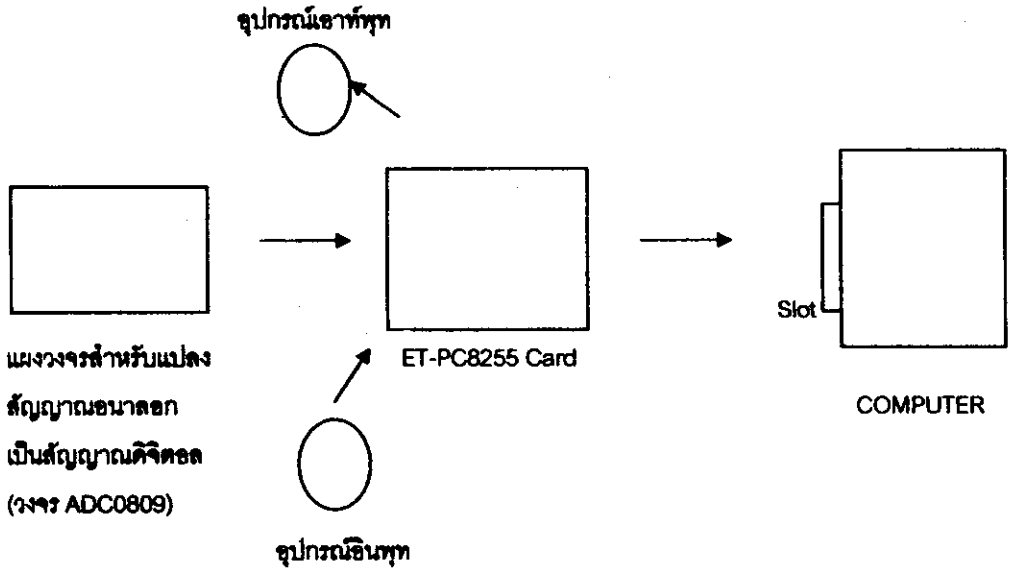
รูปที่ 2.2 การจัดเครื่องมือเพื่อตรวจสอบเฟสของสารด้วยเครื่อง XRD

2.3 การจัดเตรียมแผงวงจรเชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมสำหรับการวัดและควบคุมทั่วไป

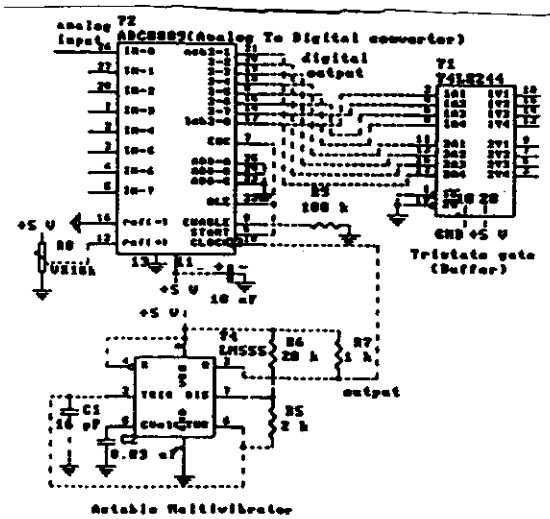
จัดเตรียมแผงวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสำหรับการวัดและควบคุมทั่วไปโดยให้สามารถอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า ทำได้โดยการประกอบวงจรการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลพร้อมกับบัฟเฟอร์ลงบนโปรโตบอร์ดแล้วทดสอบจนใช้ได้ นำแผงวงจรที่ทำได้ประกอบเข้ากับการ์ดเชื่อมต่อ (interface card) และคอมพิวเตอร์ทางสลอต (slot) เขียนโปรแกรมแล้วทดสอบจนใช้ได้ แผงวงจรนี้จะนำไปใช้ทดสอบสารต่อไป

2.3.1 การจัดเตรียมวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และ ET-PC8255 Card

ได้ประกอบวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล (ADC0809) และบัฟเฟอร์ (buffer) (74LS244) ได้ศึกษาการ์ด ET-PC8255 การ์ด (card) นี้ประกอบด้วยไอซี 8255 สามตัวทำหน้าที่เป็นอินพุตพอร์ท (input port) 8 บิต และเอาพุตพอร์ท (output port) 8 บิต การ์ดนี้จะเสียบกับสลอตของคอมพิวเตอร์ บล็อกไดอะแกรมของการเชื่อมต่อแผงวงจรกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง ET-PC8255 Card แสดงดังรูปที่ 2.3.1 วงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ET-PC8255 Card และคอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 2.3.2 ส่วนการ์ด ET-PC8255 (ET-PC8255 Card) แสดงดังรูปที่ 2.3.3

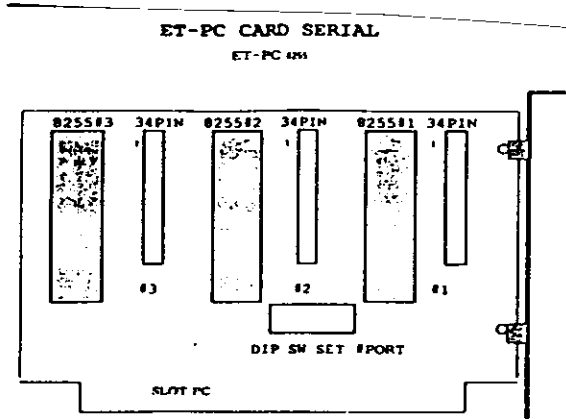


รูปที่ 2.3.1 บล็อกไดอะแกรมของการเชื่อมต่อแผงวงจรกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง ET-PC8255 Card



รูปที่ 2.3.2 วงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ET-PC8255 Card และคอมพิวเตอร์

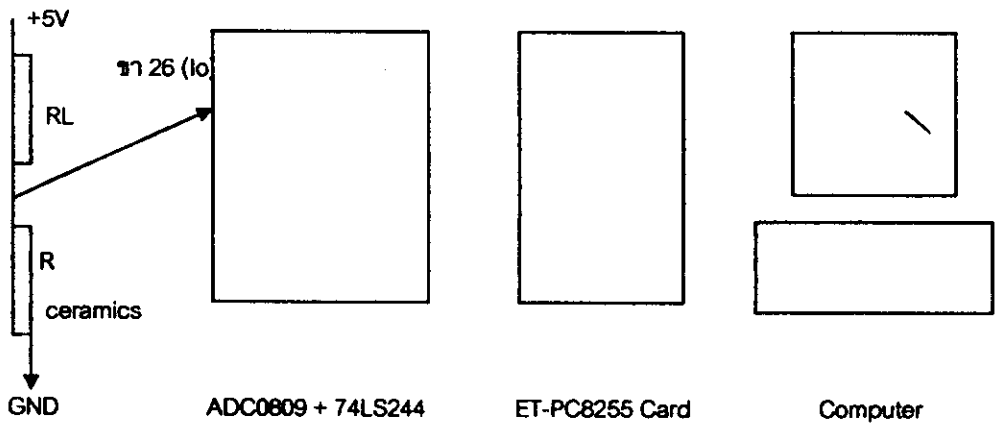
ฝ่ายทดสอบ
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร



รูปที่ 2.3.3 การ์ด ET-PC8255 (ET-PC8255 Card)

2.3.2 การวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมก้อนเซรามิกส์ (V)

ได้เชื่อมคอมพิวเตอร์กับวงจรเชื่อมต่อสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเซรามิกส์แสดงดังรูปที่ 2.3.4



รูปที่ 2.3.4 การใช้คอมพิวเตอร์วัด แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมก้อนเซรามิกส์

วัสดุอุปกรณ์

ก้อนเซรามิกส์ มัลติมิเตอร์ คอมพิวเตอร์ วงจรเชื่อมต่อพร้อมโปรแกรม ET-PC8255 Card เครื่องพิมพ์
วิธีการทดลอง

- 1 ให้ประกอบวงจร ADC0809 และ ET-PC8255 Card กับคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 2.3.2 และ 2.3.4)
- 2 เขียนโปรแกรมสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ภาษาเทอร์โบปาสคาล
- 3 สั่ง RUN อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าบนจอคอมพิวเตอร์ แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากมัลติมิเตอร์

โปรแกรมคำนวณวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมก้อนเซรามิกส์

Program DC_Voltage_Measurement;

uses crt;

var i, j, DV : integer;

AV, V : real;

ch : char;

const PA = \$0304;

Pcontrol = \$0307;

begin

clrscr;

port[Pcontrol] := \$90;

repeat

for i:=1 to 100 do

begin

for j := 1 to 255 do

begin

gotoxy(21,2); writeln('DC VOLTAGE MEASUREMENT EXPERIMENT');

gotoxy(21,3); writeln('-----');

DV := port[PA];

AV := (5/255)*DV;

V:=AV; {V}

gotoxy(26,15); writeln('DC voltage = ',V:3:4);

gotoxy(46,15); writeln("V");

delay(100);

end;

end;

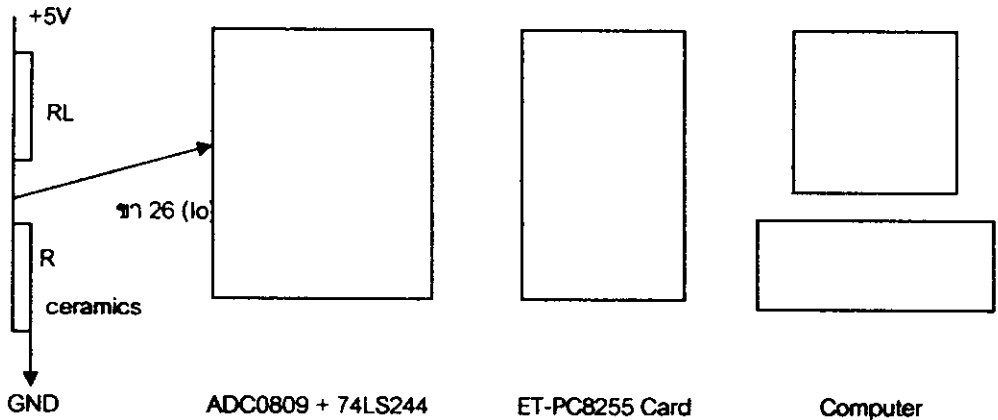
ch := readkey;

until ord(ch) = 27;

end.

2.3.3 การวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านก้อนเซรามิกส์ (I)

ได้เชื่อมคอมพิวเตอร์กับวงจรเชื่อมต่อสำหรับวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านก้อนเซรามิกส์แสดงดังรูปที่ 2.3.5



รูปที่ 2.3.5 การใช้คอมพิวเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านก้อนเซรามิกส์

วัตถุประสงค์

ก้อนเซรามิกส์ มัลติมิเตอร์ คอมพิวเตอร์ วงจรเชื่อมต่อพร้อมโปรแกรม ET-PC8255 Card เครื่องพิมพ์
วิธีการทดลอง

- 1 ให้ประกอบวงจร ADC0809 และ ET-PC8255 Card กับคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 2.3.2 และ 2.3.5)
- 2 เขียนโปรแกรมสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้ภาษาเทอร์โบปาสคาล
- 3 สั่ง RUN อ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนจอคอมพิวเตอร์ แล้วเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากมัลติมิเตอร์

โปรแกรมสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านก้อนเซรามิกส์

```
Program DC_Current_Measurement;
```

```
uses crt;
```

```
var j, k, DV      : integer;
```

```
    AV, R, Ia, I  : real;
```

```
const PA        = $0304;
```

```
    Pcontrol = $0307;
```

```
begin
```

```
    clrscr;
```

```
    port[Pcontrol] := $90;
```

```
    gotoxy(21,2); writeln('DC CURRENT MEASUREMENT EXPERIMENT');
```

```
    gotoxy(21,3); writeln('_____');
```

```

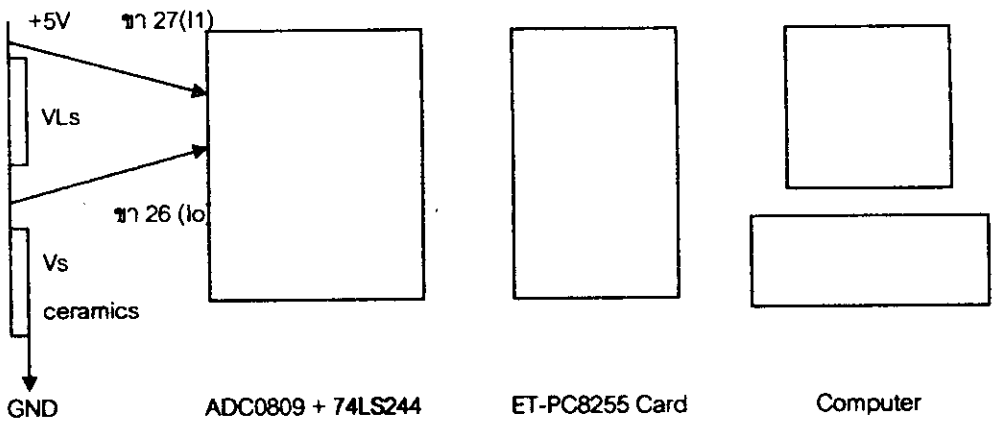
for j := 1 to 10 do
begin
  for k := 1 to 255 do
  begin
    DV := port[PA];
    AV := (5/255)*DV;
    V:=AV;
    Ia := AV/R; {A}
    I:=Ia*1000; {mA}
    gotoxy(27,15); writeln('DC current = ',I:3:5);
    gotoxy(46,15); writeln('mA');
    delay(100);
  end;
end.

```

2.3.4 การวัดความต้านทานไฟฟ้าของก้อนเซรามิกส์ (R)

ได้เชื่อมคอมพิวเตอร์กับวงจรเชื่อมต่อสำหรับวัดความต้านทานไฟฟ้าของก้อนเซรามิกส์แสดงดังรูปที่

2.3.6



รูปที่ 2.3.6 การใช้คอมพิวเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าที่ไหลผ่านก้อนเซรามิกส์

วัสดุอุปกรณ์

ก้อนเซรามิกส์ มัลติมิเตอร์ คอมพิวเตอร์ วงจรเชื่อมต่อพร้อมโปรแกรม ET-PC8255 Card เครื่องพิมพ์

วิธีการทดลอง

- 1 ให้ประกอบวงจร ADC0809 และ ET-PC8255 Card กับคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 2.3.2 และ 2.3.6)
- 2 เขียนโปรแกรมสำหรับการวัดความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้ภาษาเทอร์ริบาสคาล
- 3 สั่ง RUN อ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าบนจอคอมพิวเตอร์โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากมัลติมิเตอร์

โปรแกรมสำหรับวัดความต้านทานไฟฟ้าของก้อนแรมมิคส์

```

Program DC_Resistance_Measurement;
uses crt;
var j, k, DV0, DV1                : integer;
    AV0, AV1, RL, Vs, VLs, VL, IL, Is, I, R, Rk, Rm : real;
const PA    = $0304;
    PB      = $0305;
    Pcontrol = $0307;
begin
  clrscr;
  port[Pcontrol] := $90;
  RL := 10000; {ohm}
  gotoxy(26,2); writeln('DC RESISTANCE MEASUREMENT EXPERIMENT');
  gotoxy(26,3); writeln('-----');
  for j := 1 to 1000 do
  begin
    for k := 1 to 255 do
    begin
      port[PB] := 0;      {I0}
      delay(15);
      DV0 := port[PA];
      AV0 := (5/255)*DV0;
      Vs::=AV0; {V}
      delay(100);
      port[PB] := 1;      {I1}
      delay(15);
      DV1 := port[PA];

```



```

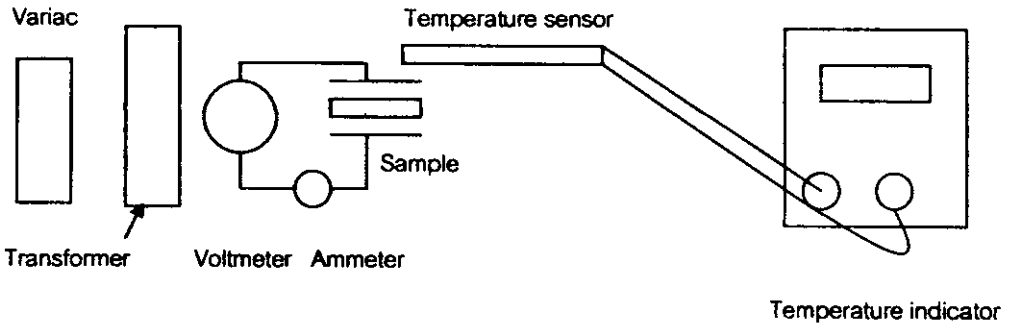
AV1 := (5/255)*DV1;
VLs := AV1;
VL := (VLs-Vs);
IL := (VL/RL);
Is := IL; {A}
delay(15);
R := Vs/Is; { $\Omega$ }
Rk:=R/1000; {k $\Omega$ }
Rm:=Rk/1000; {M $\Omega$ }
gotoxy(24,15); writeln('resistance = ',R:3:2);
gotoxy(46,15); writeln('' $\Omega$ '');
gotoxy(24,17); writeln('resistance = ',Rk:3:2);
gotoxy(46,17); writeln('k $\Omega$ '');
gotoxy(24,19); writeln('resistance = ',Rm:3:2);
gotoxy(46,19); writeln('M $\Omega$ '');
delay(100);
end;
end.

```

2.4 การทดสอบสารให้ความร้อน

2.4.1 การวัดกำลังไฟฟ้าที่จ่ายกับอุณหภูมิของสารให้ความร้อนที่ทำได้

จัดชุดทดลองดังแสดงในรูปที่ 2.4.1 สารที่ทดลอง คือ $ZnO+0.01Nb_2O_5$ ป้อนแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เข้าทางแอมมิเตอร์ ส่งแรงดันไฟฟ้าจากแอมมิเตอร์เข้าทางอินพุตของหม้อแปลงไฟฟ้า จ่ายแรงดันเอาต์พุตจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังสาร พบว่าสารเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (V) และ กระแสไฟฟ้า (I) ใช้เครื่องอ่านอุณหภูมิและเทอร์โมคอปเปิล วัดอุณหภูมิของสาร (T) คำนวณกำลังไฟฟ้า (P) จาก สูตร $P=VI$ บันทึกค่าลงในตารางแล้วพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับกำลังไฟฟ้าที่ป้อน ให้แก่สาร (T vs P)

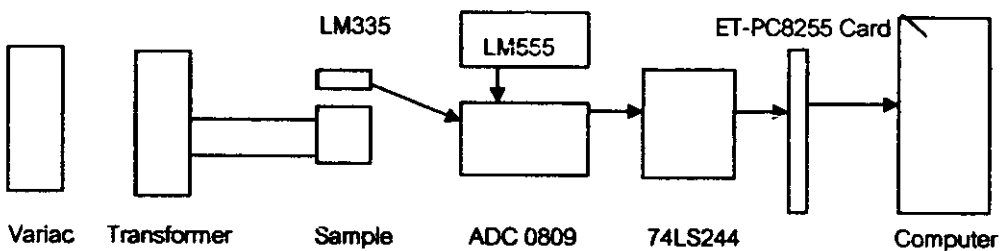


รูปที่ 2.4.1 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับกำลังไฟฟ้าที่ป้อนสำหรับสารให้ความร้อน

2.4.2 การวัดอุณหภูมิที่ขึ้นกับเวลาของสารให้ความร้อนด้วยคอมพิวเตอรื

สารที่ทดสอบ คือ $ZnO+0.02TiO_2$ การวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามเวลาของสารให้ความร้อนด้วยคอมพิวเตอรืทำได้โดยใช้แผงวงจรและโปรแกรมที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้ามีมาปรับปรุง เลือกหัววัดอุณหภูมิที่เหมาะสม ปรับสเกลที่ใช้วัดอุณหภูมิ ตรวจสอบการวัดเวลาอีกครั้ง การทดลองมีขั้นตอนดังนี้

- 1) ออกแบบและสร้างวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืสำหรับการทดสอบการให้ความร้อนดังรูปที่ 2.4.2



รูปที่ 2.4.2 บล็อกไดอะแกรมสำหรับการแสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นตามเวลาของสารให้ความร้อน $ZnO+0.02TiO_2$ ด้วยคอมพิวเตอรื

- 2) ทดสอบการเชื่อมต่อสำหรับการวัดอุณหภูมิของสารให้ความร้อนด้วยคอมพิวเตอรื
- 3) เขียนโปรแกรมเทอร์โมปาสตาคาลสำหรับให้คอมพิวเตอรืแสดงอุณหภูมิที่ขึ้นกับเวลาแล้วแล้วก็ทดสอบโปรแกรมนี้

Program for computer displaying the temperature versus time

Program Heating_Element_Temperature_vs_Time_Graph;

uses crt, graph;

var gdriv, gmode, gerror : integer;

ch : char;

```

DV          : integer;
const PA    = $0304;
Pcontrol = $0307;

procedure axis;
var p,q : integer;
    tex : string;
begin
  grdrv:=detect ; initgraph(grdrv,grmode,'c:\tp\bgi');
  setgraphmode(grmode);
  line(50,50,50,305) ; line(50,305,600,305);
  line(50,50,600,50) ; line(600,50,600,305);
  settextstyle(defaultfont , horizdir,0);
  for p := 50 to 600 do
  begin
    if p mod 110 = 0 then
      begin
        line(p+50, 295, p+50, 305); str(round(p/110),tex);
        outtextxy(p+50, 320, tex);
      end;
    end;
  settextstyle(defaultfont , horizdir,0);
  for q:= 50 to 305 do
  if q mod 51 = 0 then
  begin
    line(45,q,55,q) ; str((((305-q) mod 5)+1)*20, tex);
    outtextxy(20,q,tex)
  end;
  end;
  end;
procedure plot ;
var i, j, x, y, DV : integer;
    AV, VT, T : real;
begin
  outtextxy(235,10, TEMPERATURE VS TIME OF HEATING ELEMENT GRAPH );

```

```

outtextby(235,18,-----);
outtextby(50,30, Temperature (°C));
outtextby(540,340,Time (min));
outtextby(48,303,"");
begin
  DV := 0; AV:= 0;
  port [Pcontrol ]:=$90;
  for j:=0 to 550 do
    begin
      DV:=port[PA];
      AV:=(5/255)*DV;
      VT:=AV;
      T:=(VT-2.73)/(0.01);
      x:=j+50 ; y:=305-round((255/100)*T);
      lineto(x,y);
    end;
  delay(600)
end;
end;
readln;
closegraph;
end;
begin (main)
  repeat
    axis;
    plot;
    ch:=readkey;
  until ord(ch) = 27;
end.

```

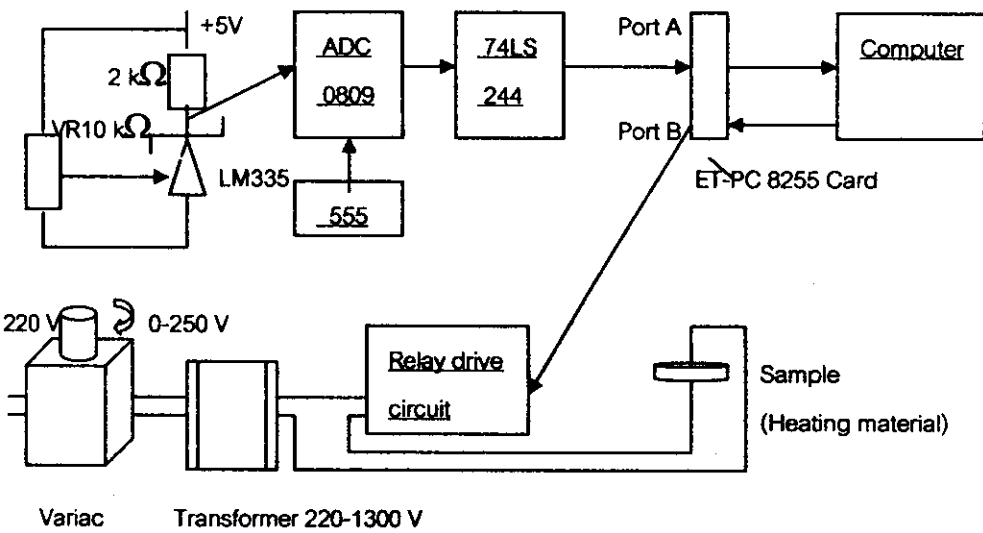
- 3) ได้วงจรระบบไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าผ่านสารตัวอย่างใดก็ตามเพื่อแปลงความร้อนเป็นไฟฟ้า
- 4) วัตถุประสงค์ของสารตัวอย่างด้วย LM335 ซึ่งได้วางบนพื้นผิวของสาร LM335 เป็นตัววัดอุณหภูมิที่ทำงานจากสารที่ตัวนำ

- 5) ได้ส่งแรงดันไฟฟ้าจากหัววัดนี้เข้าขา 26 (I₀) ของ ADC0809 สำหรับการแปลงแรงดันอนาล็อก (AV) แปลงแรงดันดิจิทัล แรงดันดิจิทัล 8 บิต ซึ่งประกอบด้วย D7,D6,D5,D4,D2,D1,D0 ผ่าน 74LS244 สำหรับการทำบัฟเฟอร์ (buffering) ส่งแรงดันไฟฟ้าไปยัง ET-PC8255 Card แล้งผ่านพอร์ท A ของ IC8255 แล้วเข้าไปใน RAM โปรแกรมจะแสดงแรงดัน DV บนจอคอมพิวเตอร์ แปลงแรงดัน DV ให้เป็น AV แล้วแสดงบนจอ
- 6) แปลงแรงดัน AV ให้เป็นอุณหภูมิ (T)
- 7) ในที่สุดคอมพิวเตอร์สามารถอ่านอุณหภูมิของสารให้ความร้อนด้วยหัววัดอุณหภูมิ LM335
- 8) ได้ผลที่แสดงให้เห็นว่าสารที่เตรียมได้แสดงสมบัติให้ความร้อน

2.4.3 การควบคุมอุณหภูมิของสารให้ความร้อนให้คงที่

การควบคุมอุณหภูมิของสารให้ความร้อนให้คงที่ทำได้โดยการสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิของสารให้ความร้อนด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้โดยใช้แผงวงจรที่ได้ทำไว้ เขียนโปรแกรมให้จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสารเป็นจังหวะ และให้ตัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโดยอาศัยการทำงานของวงจรถอยกลับและรีเลย์สแตทิสต์

1. จัดเตรียมวงจรเชื่อมต่อสำหรับให้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิของสารให้ความร้อน (รูปที่ 2.4.3)



รูปที่ 2.4.3 บล็อกไดอะแกรมที่แสดงการให้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิของสารให้ความร้อน

- 2) เขียนโปรแกรม

```
Program Heating_Material_Temperature_Control;
```

```
uses crt;
```

```
var
```

```
ch : char;
```

```

i, j, DV      : integer;
AV, VT, T, Ts : real;

const
PA      = $0304;      กำหนด address ของพอร์ท A ของ IC 8255
PB      = $0305;      กำหนด address ของพอร์ท B ของ IC 8255
Pcontrol = $ 0307;    กำหนด address ของพอร์ท ความคุม ของ IC 8255

begin
port[Pcontrol] := $90;   กำหนด control word สำหรับให้พอร์ท A/B เป็นพอร์ทอินพุท/เอาต์พุท
Ts := 0;
clrscr;
gotoxy(14,1); writeln('HEATING MATERIAL TEMPERATURE CONTROLLED VALUE');
gotoxy(14,2); writeln('-----');
gotoxy(25,4); writeln('Setting Temperature = --- ,Ts:3:0);
gotoxy(50,4); writeln('C');
gotoxy(47,4); readln(Ts); ตั้งค่าอุณหภูมิทำงานของเตาไฟฟ้า
repeat
    gotoxy(33,12); writeln('Experiment Start');
    port[PB] := 255; ส่งแรงดัน 5 V ไปยังวงจรรีเลย์ เพื่อให้สวิตช์รั้ว 3 ต่อกับขั้ว 4
    delay(500);   ตั้งให้หน่วงเวลาสำหรับให้รีเลย์จ่ายไฟทำให้แม่สารให้ความร้อน
    sound(900); delay(10); nosound;
    gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
    DV := port[PA]; ส่งให้รับแรงดันดิจิทัลซึ่งมาจากหัววัดอุณหภูมิ (LM335)
    gotoxy(35,17); writeln('DV = ',DV:3);
    AV := (5/255)*DV;   ส่งให้แปลงแรงดันดิจิทัลเป็นแรงดันอนาลอก
    gotoxy(34,18); writeln('AV = ',AV:1:2, 'V');
    VT:=AV;
    T :=(VT-2.73)/(0.01);   ส่งให้แปลงแรงดันอนาลอกเป็นอุณหภูมิ
    gotoxy(34,22); writeln('T = ',T:3:2);   ส่งให้แสดงค่าอุณหภูมิของเตาที่อ่านได้บนจอ
    gotoxy(43,22); writeln('C');
    port[PB] := 0;   ส่งแรงดัน 0 V ไปยังวงจรรีเลย์เพื่อให้สวิตช์รั้ว 3 ไม่ต่อกับขั้ว 4
    delay(2000);   ตั้งให้หน่วงเวลาสำหรับให้รีเลย์หยุดจ่ายไฟทำให้แม่สารให้ความร้อน
    sound(9000); delay(10); nosound;
until T>Ts;   ทำซ้ำจนถึงอุณหภูมิทำงานของเตาไฟฟ้าที่ตั้งไว้

```



```
gotoxy(39,24); writeln("END");
```

```
delay(5000);
```

```
end.
```

3) สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรม (RUN) คอมพิวเตอร์จะส่งแรงดัน 5 V มาয়ังวงจรขั้วรีเลย์ สวิตช์ชั่วคราว 3 ต่อกับ 4 ต่อกัน กระแสไฟฟ้าที่มาจากวงจรแอคซึ่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ามาแล้วจะไหลผ่านสารให้ความร้อน สารร้อนขึ้น LM335 อ่านอุณหภูมิของสาร ส่งแรงดันไฟฟ้าจากหัววัดนี้เข้าทางขา 26 (I_p) ของ ADC0809 ไอซี ADC0809 จะทำหน้าที่แปลงแรงดันอนาล็อก (AV) เป็นแรงดันดิจิทัล (DV) แรงดันดิจิทัลขนาด 8 บิต ถูกส่งผ่าน 74LS244 ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ส่งแรงดันดิจิทัล 8 บิต D7,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0 นี้ไปยัง ET-PC8255 Card และให้ผ่านทางพอร์ท A ของ IC8255 แล้วเข้าไปในแรม สั่งให้แสดงค่า DV บนจอ แปลง DV เป็น AV สั่งให้แสดงค่า AV บนจอ แปลง AV ให้เป็น DV แปลงแรงดัน AV ให้เป็นอุณหภูมิของสารให้ความร้อน (T) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แสดงอุณหภูมิของสารนั้นบนจอ คอมพิวเตอร์จะส่งแรงดัน 0 V มาয়ังวงจรขั้วรีเลย์ สวิตช์ชั่วคราว 3 ไม่ต่อกับ 4 ต่อกัน กระแสไฟฟ้าหยุดไหลผ่านสารให้ความร้อน สารเย็นขึ้น LM335 อ่านอุณหภูมิของสาร คอมพิวเตอร์อ่านอุณหภูมิของสารแล้วแสดงผลบนจอ ให้มีการจ่ายและหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสารเพื่อให้เกิดการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ อุณหภูมิคงที่ได้ตั้งไว้ในโปรแกรมประมาณ $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง

4) ส่งพิมพ์ภาพบนจอในขณะที่ระบบกำลังทำงาน

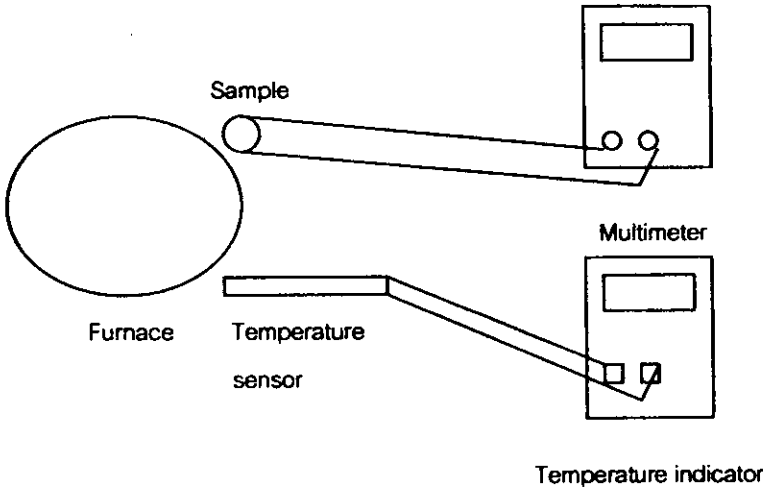
2.5 การทดสอบเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC

2.5.1 การวัดเสถียรภาพทางไฟฟ้าเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC

วัดเสถียรภาพทางไฟฟ้า (ΔR vs Δt) ทำได้โดยวัดความต้านทานไฟฟ้าของสารที่เวลาต่างๆ ในขณะที่อุณหภูมิของสารคงที่ สาเหตุที่ต้องวัดเพราะว่าความต้านทานไฟฟ้าสารที่ใช้ทำหัววัดอุณหภูมิจะคงไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยน

2.5.2 การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC โดยใช้โอห์มมิเตอร์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ

ใช้ตัวจับพร้อมขาตั้งยึดก้อนสารที่ทำหัววัดด้วยกาวเงินให้อยู่เหนือเตาไฟฟ้าที่ประมาณ 0.5 เซนติเมตร วัดความต้านทานไฟฟ้า (R) ด้วยเครื่องมือดิจิทัลมิเตอร์ (Fluke 45 Dual Display Multimeter) และอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (AVD M890C) โดยที่ก้อนสารกับหัววัดอุณหภูมิอยู่ที่ระดับเดียวกันดังแสดงในรูปที่ 2.5.1 หลังจากนั้น ให้เพิ่มอุณหภูมิของสารอย่างช้าๆ บันทึกความต้านทานไฟฟ้า (R) และอุณหภูมิ (T) ลงในตาราง เขียนกราฟ R vs T หาสมประสิทธิ์อุณหภูมิของสารที่ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นลบหรือค่าความไวของเทอร์มิสเตอร์ทั้งในย่านสูงกว่าหรือต่ำกว่าอุณหภูมิห้องจากสูตรโดยอาศัยข้อมูลของความชันของกราฟ



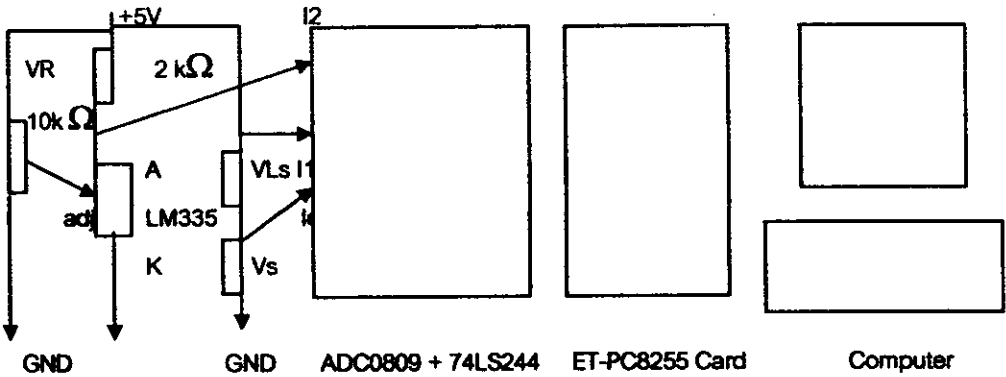
รูปที่ 2.5.1 การวัดความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆด้วยโพรบมิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิ

2.5.3 การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ด้วยคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เทอร์มิสเตอร์แบบ NTC แหล่งให้ความร้อน (เตาไฟฟ้า) มัลติมิเตอร์ LM335 เครื่องวัดอุณหภูมิ คอมพิวเตอร์ วงจรเชื่อมต่อกับโปรแกรม เครื่องพิมพ์ มีชิ้นคอนดักนี้

1) สร้างระบบการวัดความต้านทานไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้โดยใช้แผงวงจรสำหรับอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าและอุณหภูมิ (ย่านสูงกว่าอุณหภูมิห้อง)(RvsT) LM335 เป็นตัววัดอุณหภูมิที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -10°C ถึง 100°C การจัดระบบการวัดแสดงดังรูปที่ 2.5.2



รูปที่ 2.5.2 การใช้คอมพิวเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆ

2) ใช้คอมพิวเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆ (รูปที่ 1) บันทึกผลโดยใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์กราฟ

โปรแกรมคำนวณวัดความต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆของวัสดุ

Program Resistance_vs_Temperature_Data;

uses crt;

var i, j, DV : integer;

AV, R, RL, Vs, VLs, VL, IL, VT, Is, T : real

const PA = \$0304;

PB = \$0305;

Pcontrol = \$0307;

begin

clrscr;

port[Pcontrol] := \$90;

RL := 10000;

gotoxy(21,2); writeln('RESISTANCE VS TEMPERATURE DATA');

gotoxy(21,3); writeln('-----');

for i := 1 to 1000 do

begin

for j := 1 to 255 do

begin

port[PB] := 0; {I0}

delay(15);

DV := port[PA];

AV := (5/255)*DV;

Vs := AV;

port[PB] := 1; {I1}

delay(15);

DV := port[PA];

AV := (5/255)*DV;

VLs := AV;

VL := abs(VLs-Vs);

IL := (VL/RL);

Is := IL;

```

R := (Vs/Is);
gotoxy(48,14); writeln('Resistance = ',R:3:3, 'Ω');
port[PB] := 2;           {I2}
delay(15);
DV := port[PA];
AV := (5/255)*DV;
VT := AV;
T := (VT-2.73)/(0.01);
gotoxy(2,14); writeln('Temperature = ',T:3:3, 'deg C');
delay(100);
end;
end;
end.

```

Program Resistance vs Temperature 10 kohm 100 degC Graph:

```

uses crt, graph;
var DV, grdrv, grmode, grrror : integer;
    ch                          : char;
const PA      = $0304;
    PB      = $0305;
    Pcontrol = $0307;
procedure axis;
var p, q : integer;
    tex : string;
begin
    grdrv := detect; initgraph(grdrv, grmode, 'C:\tp\bgi');
    setgraphmode(grmode);
    line(20,40,20,440); line(20,440,620,440);
    line(20,40,620,40); line(620,40,620,440);
    settxtstyle(defaultfont, horizdir,0);
    for p := 20 to 620 do
        begin
            if p mod 30 = 0 then

```

```

begin
    line(p-20,435,p-20,445); str(round((p-20)/30)*5,tex);
    outtextxy(p-20),450,tex);
end;

settextstyle(defaultfont,horizdir,0);
for q := 40 to 440 do
begin
    if q mod 40 = 0 then
        begin
            line(15, q-40, 25, q-40); str(round((400-q)/80+1,tex);
            outtextxy(5,q-40,tex);
        end;
    end;
end;

procedure plot;
var i, j, x, y, DV1, DV2, Dv3                : integer;
    AV1, AV2,AV3, R, RL, Vs, VLs, VL, IL, VT ,Is, T : real;
begin
    outtextxy(200,2, 'RESISTANCE VS TEMPERATURE CURVE');
    outtextxy(200,10, '-----');
    outtextxy(20,26, 'Material Resistance (kohm) ');
    outtextxy(470,465, 'Temperature ( C)');
    outtextxy(50,440, '');
    port[Pcontrol] := $90;
    for i := 1 to 550 do
        begin
            port[PB] := 0;          {I0}
            delay(15);
            DV1 := port[PA];
            AV1 := (5/255)*DV1;
            Vs := AV1;
            port[PB] := 1;          {I1}
            delay(15);

```

```

DV2 := port[PA];
AV2 := (5/255)*DV2;
VLs := AV2;
VL := abs(VLs-Vs);
IL := (VL/RL)*1000;
Is := IL;
R := (Vs/Is)*1000;
port[PB] := 2;      {I2}
delay(15);
DV3 := port[PA];
AV3 := (5/255)*DV3;
VT := AV3;
T := (VT-2.73)/(0.01);
x := round(50+T*(550/100)); y := round(440-R*(440/10));
line(x,y,x,y);
delay(10);
end;

```

```
end;
```

```
begin      {main}
```

```
repeat
```

```
axis;
```

```
plot;
```

```
ch := readkey;
```

```
until ord(ch) = 27;
```

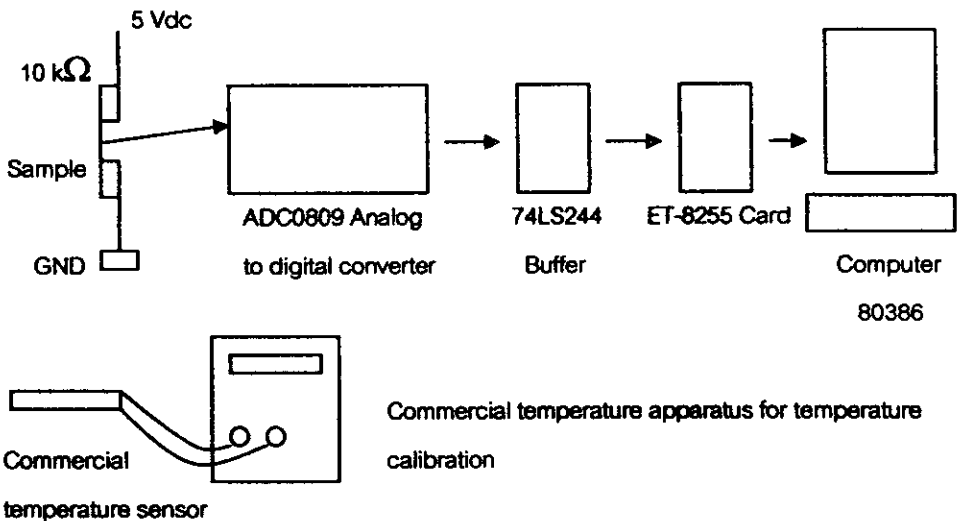
```
end.
```

2.5.4 การทดสอบของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดอุณหภูมิด้วยคอมพิวเตอร์ ทดสอบหัววัดอุณหภูมิที่แสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้โดยใช้แผงวงจรที่สร้างขึ้น ทดสอบในช่วง 26 °C

ถึง 100 °C เขียนโปรแกรมการปรับเทียบค่า (calibration) โดยอาศัยเครื่องวัดอุณหภูมิเชิงการค้า เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิ ระบบการวัดมีการคัดแปลงหรือปรับปรุงในขณะที่ทดลองเรื่องนี้
ขั้นตอน มีดังนี้

- 1) ประกอบวงจรเชื่อมต่อ ADC0809 ลงบนโปรแกรมบอร์ดแล้วต่อกับ ET-PC8255 Card และคอมพิวเตอร์และทดสอบงานใช้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.5.3

- 2) เขียนโปรแกรมควบคุมการวัดด้วยภาษาเทอร์โบปาสคาล
- 3) ทำการปรับเทียบเครื่องมือ (instrument calibration) โดยจ่ายแรงดันตกคร่อมสารที่เตรียมได้ซึ่งจะถูกทดสอบให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดอุณหภูมิ สัญญาณตอบสนองจะถูกป้อนเข้าไอซี ADC 0809 ซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงดันอนาล็อกให้เป็นแรงดันดิจิทัล ไอซี 74LS244 จะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ (buffer) แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารซึ่งเป็นแรงดันอนาล็อกจะเคลื่อนที่ผ่าน ET-PC8255 Card ผ่านสล็อต (slot) เข้าไปโนแรม (RAM) ใช้คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ (80386SX) แสดงแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสาร(แรงดันอนาล็อก)บนจอ เพิ่มอุณหภูมิของสารโดยใช้เตาไฟฟ้า อ่านอุณหภูมิจากเครื่องวัดจริง(true)ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (Union 305) ซึ่งใช้เทอร์โมคอปเปิลชนิด K เป็นหัววัดและแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสาร(AV)บนจอคอมพิวเตอร์ ในช่วง 26°C ถึง 100°C แล้วบันทึกผลลงในตารางและแสดงความสัมพันธ์ของ T_{true} vs AV ด้วยโปรแกรม EXCEL เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นั้นลงในโปรแกรมควบคุมการวัด เพื่อที่จะเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิจากเครื่องวัดจริง (T_{true}) กับอุณหภูมิจากเครื่องที่สร้างขึ้น (T_{measure}) ได้เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์นั้นลงในโปรแกรมควบคุมการวัดแล้ว คอมพิวเตอร์ก็สามารถอ่านอุณหภูมิโดยใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัด คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นเครื่องที่สร้างขึ้น เพิ่มอุณหภูมิของสารโดยใช้เตาไฟฟ้า ให้เครื่องวัดจริงอ่านอุณหภูมิ T_{true} และเครื่องที่สร้างขึ้น(คอมพิวเตอร์)อ่านอุณหภูมิ T_{measure} บันทึกผลลงในตารางแล้วพลอตกราฟแท่ง
- 4) เมื่อได้ทำตามขั้นตอน 1 ถึง 3 แล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัดจะทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องหนึ่ง ทดลองโดยนำไปวัดอุณหภูมิในช่วง 26°C ถึง 100°C เพื่อที่จะดูว่าอ่านอุณหภูมิได้หรือไม่



รูปที่ 2.5.3 Interfacing circuit with computer's preparation for temperature measurement by using $\text{MnO}+0.04\text{CuO}$'s prepared sample sensor

```

Program Temperature_Sensor_Testing;
uses crt;
var i, j, x, y, DV : integer;
    AV, Ttrue : real;
const PB = $0305;
    Pcontrol = $0307;
begin
  clrscr;
  port[Pcontrol] := $82;
  gotoxy(23,2); writeln('TEMPERATURE MEASUREMENT');
  gotoxy(23,3); writeln('-----');
  DV:=0; AV:=0; Ttrue:=0;
  for i := 1 to 100 do
  begin
    for j := 1 to 255 do
    begin
      DV := port[PB];
      AV := (5/255)*DV;
      gotoxy(26,14); writeln('Analog Voliage = ',AV:3:3, ' V');
      delay(1)
      Ttrue := (33.887*AV*AV) - (230.08*AV)+ 417.3;
      gotoxy(20,20); writeln('*****')
      gotoxy(17,22); writeln('Measure Temp = ',Ttrue:3:2, ' C');
      delay(1);
      gotoxy(15,24); writeln('>>>*****<<<<');
      delay(500);
    end;
  end;
end.

```

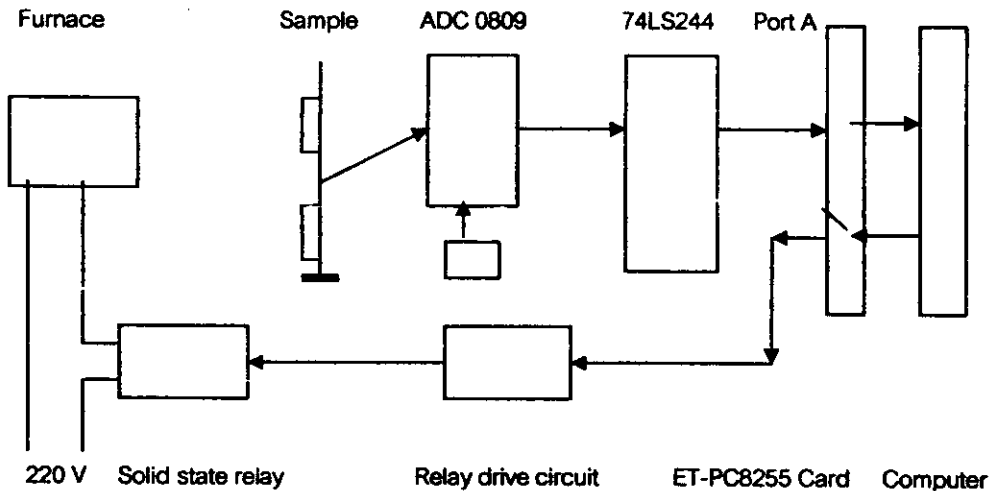
2.5.5 การทดสอบของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดและควบคุมอุณหภูมิด้วยคอมพิวเตอรื

ทดสอบหัววัดสัญญาณป้อนกลับในระบบควบคุมอุณหภูมิเกินในย่านสูงกว่าอุณหภูมิห้องสามารถทดสอบโดยให้คอมพิวเตอรืควบคุมการจ่ายไฟฟ้าผ่านโรลิสต์เทรียลย์เข้าเตาไฟฟ้า หัววัดอุณหภูมิจะสร้างสัญญาณป้อนกลับมายังคอมพิวเตอรื ถ้าอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าเกิน ขนาดของสัญญาณป้อนกลับจะมีค่าเพียงพอทำให้โรลิสต์เทรียลย์หยุดทำงาน

2.5.5.1 ส่วนสูงกว่าอุณหภูมิห้อง

มีขั้นตอนดังนี้

- 1) ทำการทดสอบสารให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดอุณหภูมิโดยการประกอบอุปกรณ์ลงบนโปรโตบอร์ดโดยอาศัยวงจรเชื่อมต่อที่ได้เตรียมไว้ ดังแสดงในรูปที่ 2.5.4 หลังจากนั้นก็ป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในวงจร ตรวจสอบว่าใช้ได้ถ้าวงจรใช้ได้ เมื่อเราปรับที่ $VR10k\Omega$ การติดดับของ LED จะเปลี่ยนไปมา



รูปที่ 2.5.4 แสดงบล็อกไดอะแกรมคอมพิวเตอรืทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัด

- 2) เขียนโปรแกรม OUTPUT ด้วยภาษาเทอร์โมปาสคาล เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าออกทางพอร์ท B เป็นการเช็คเพื่อให้ทราบว่าจะจริงที่ต่ออื่นใช้งานได้ สังเกตจากได้จากการติดดับของ LED ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากคอมพิวเตอรืเป็น 5 V LED จะติด แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากคอมพิวเตอรืเป็น 0 V LED จะดับ การนำแรงดันไฟฟ้าออกนอกคอมพิวเตอรืจะใช้คำสั่ง $Port[PB]:=0$ หรือ $Port[PB]:=255$

- 3) เขียนโปรแกรม INPUT ด้วยภาษาเทอร์โมปาสคาล เพื่อให้คอมพิวเตอรืสามารถอ่านหรือรับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเชื่อมต่อ แรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ด้วย $VR10 k\Omega$ ถูกป้อนเข้าทางขา 26 (I) ของ ADC0809 แรงดันไฟฟ้าที่นี้เรียกว่า แรงดันขนาดออก ADC0809 จะทำหน้าที่แปลงแรงดันขนาดออก (AV) เป็นแรงดันดิจิทัล (DV) วงจร IC555

จะทำหน้าที่ผลิตแรงดันรูปสี่เหลี่ยมแล้วส่งเข้าขา 10 ของ ADC0809 เพื่อให้ IC ตัวนี้ ทำงาน แรงดันดิจิทัลขนาด 8 บิต ถูกส่งผ่าน 74LS244 ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ใช้ LED 8 ตัว อ่านหรือแสดงแรงดันดิจิทัลที่ output ของ 74LS244 แรงดัน 8 บิต D7,D6,D5,D4,D2,D1,D0 นี้จะถูกส่งผ่าน ET-PC8255 Card โดยผ่านทางพอร์ต A ของ IC8255 แล้วถูกส่งต่อเข้าไปใน RAM การนำแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเชื่อมต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะใช้คำสั่ง DV:=Port[PA] ใช้คำสั่ง writein(' ') ให้เครื่องแสดงค่าของ DV, AV หรือ T บนจอใช้คำสั่ง Lineto(x,y) แสดงภาพบนจอ

4) ทำการทดสอบเพื่อคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อ่านอุณหภูมิโดยใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัดซึ่งทำได้โดยเริ่มจากการนำสารที่เตรียมได้ต่ออนุกรมกับความต้านทาน 100 Ω แล้วป้อนแรงดันไฟฟ้า 5 V เข้าไป นำค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความต้านทานในขณะอุณหภูมิเปลี่ยนป้อนเข้าขา 26 (I_0) ของ ADC0809 เพื่อแปลง AV เป็น DV ส่งผ่าน 74LS244 และ ET-PC8255 Card เข้าไปใน RAM สั่งให้แสดงค่า DV บนจอ แปลง DV เป็น AV ด้วยคำสั่ง $AV:=(5/255)*DV$ สั่งให้แสดงค่า AV บนจอ เพิ่มอุณหภูมิของสารโดยใช้เตาไฟฟ้า ทำการปรับเทียบค่า (calibrate) โดยการอ่านอุณหภูมิจากเครื่องวัดจริง (True) ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (Union 305) ซึ่งใช้เทอร์โมคอปเปิลชนิด K เป็นหัววัด และแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสาร (AV) บนจอคอมพิวเตอร์ในช่วงอุณหภูมิ 24 $^{\circ}\text{C}$ ถึง 100 $^{\circ}\text{C}$ นำค่า AV กับ True ไปพลอตกราฟและแสดงสมการ $\text{True} = f(\text{AV})$ ด้วย EXCEL เขียนสมการความสัมพันธ์ของ True vs AV ลงในโปรแกรมควบคุมการวัด หลังจากนั้นก็สั่ง RUN โปรแกรม แล้วอ่านอุณหภูมิจากเครื่องวัดจริง (True) กับอุณหภูมิจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัด (Tmeasure) นำค่าทั้งสองไปพลอตกราฟเพื่อเปรียบเทียบค่า เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการปรับเทียบค่า

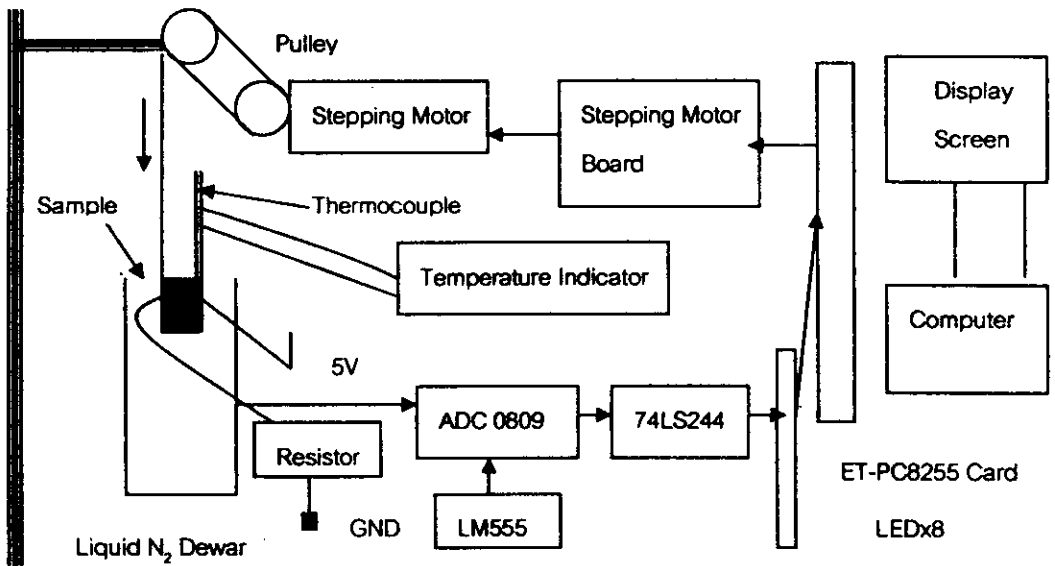
5) เราจะได้เครื่องวัดอุณหภูมิที่แสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์และใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัด

6) ทำการทดสอบสารที่เตรียมได้ให้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ วงจรเชื่อมต่อส่วนแรกจะเหมือนกับวงจรที่ได้ประกอบเตรียมไว้ วงจรส่วนที่สองที่ต่อเพิ่มเข้ามาเป็นวงจรรับรีเลย์เพื่อควบคุมรีลิตสเตรียลย์ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าเตาไฟฟ้า เขียนโปรแกรมทดสอบให้วงจรรับรีเลย์ทำการจ่ายไฟฟ้า 5V กับ 0 V สลับกัน เพื่อให้สวิตช์ของรีเลย์ทำงานในจังหวะเปิดและปิดสลับกัน การเปิดปิดสวิตช์ของรีเลย์จะไปควบคุมการทำงานของรีลิตสเตรียลย์ทำงานและหยุดทำงานสลับกันเพื่อให้เตาร้อนขึ้นในอัตราหนึ่ง คอมพิวเตอร์จะอ่านอุณหภูมิตลอดเวลา เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้ก็ให้กักให้หยุดจ่ายไฟฟ้าเข้าเตาไฟฟ้า สารที่เตรียมได้สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งหัววัดอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและแสดงผล

2.5.5.2 อ่านต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

สำหรับในย่านต่ำกว่าอุณหภูมิ มีการทดลองทำนองเดียวกัน แต่ใช้แผงวงจรสำหรับรับลบปึงมอเตอร์ประกอบด้วย สารที่ทดลองมีสูตรเป็น $\text{Mn}_0.2\text{Ni}_0.8\text{Fe}_2\text{O}_4$ ประยุกต์ใช้เป็นหัววัดและควบคุมอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า ในช่วง 0 ถึง -50 $^{\circ}\text{C}$ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

ออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าหัววัดและควบคุมอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าในช่วง 0 ถึง -50 $^{\circ}\text{C}$ แสดงดังรูป 2.5.5



รูป 2.5.5 แสดงโครงสร้างระบบจ่ายไฟฟ้า วัดและควบคุมอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง -50°C

วงจรประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกสามารถอธิบายการทำงานของระบบโดยเริ่มจากแรงดันไฟฟ้าตรง 10 V ไหลผ่านตัวต้านทานที่อนุกรมสารที่เตรียมได้ทำให้สารตัวอย่างมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนไปยัง ADC0809 เข้าทางอินพุต I_0 ซึ่งเป็นแรงดันอนาล็อก (AV) ส่งแรงดัน AV เข้า ADC 0809 ทางขา 26 เพื่อแปลงให้เป็นแรงดันดิจิตอล (DV) ซึ่งแรงดัน DV นี้จะเคลื่อนที่ผ่านบัฟเฟอร์ 74LS244 ใช้ LED 8 ตัวที่บอกแรงดันดิจิตอลทั้ง 8 บิตนี้ แรงดัน DV นี้จะผ่าน ET-PC8255 Card ทางพอร์ท A แล้วเข้าไปใน RAM โดยเก็บไว้ในตัวแปร DV ทำการแปลงแรงดัน DV เป็น AV ใช้คำสั่งให้แปลงแรงดัน AV ที่เข้าไปในเครื่องให้เป็น T สำหรับวงจรส่วนที่ 2 เป็นการนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกจาก ET-PC8255 Card ไปยังสเตปป์มอเตอร์บอร์ด (stepping motor board) เพื่อควบคุมให้สเตปป์มอเตอร์ (stepping motor) หมุนโดยใช้โปรแกรมควบคุมการหมุนของสเตปป์มอเตอร์ศึกษารายละเอียดของวงจรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตามและประกอบวงจรลงบนโปรโตบอร์ด (photobroad) หลังจากนั้นก็ทดสอบวงจรทำงานได้ หากผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Ttrue และ AV ทิศสมการลงในโปรแกรม สั่งรัน (RUN) โปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ก็จะทำหน้าที่อ่านอุณหภูมิโดยใช้สารตัวอย่างเป็นหัววัดได้ค่า Tmeasure และอ่านอุณหภูมิที่ได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิที่เข้ามา (union 305 thermometer) ได้ค่า Ttrue ทำการบันทึกผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิที่เข้ามา (Ttrue) กับอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิที่สร้างขึ้น นั่นก็คือคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอย่างเป็นหัววัด (Tmeasure) ทุกๆ 5°C ในช่วง 0 ถึง -50°C ทำการทดลอง 3 ครั้งแล้วนำผลที่ได้มาเขียนกราฟเพื่อแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิทั้งสอง แล้วนำระบบการจ่ายไฟฟ้าและควบคุมอุณหภูมิในย่านไนโตรเจนเหลวไปใช้งาน เริ่มจากเปิดคอมพิวเตอร์ เข้า

โปรแกรม เปิดสวิตช์ไฟเลี้ยงที่เข้าขดลวดของเตาไฟฟ้า สิ้นวัน (RUN)โปรแกรมและ ตั้งอุณหภูมิที่จะทำการควบคุม เครื่องก็ทำการ Enter ระบบก็จะทำงานทันที

โปรแกรม : ประยุกต์สารที่เตรียมได้ให้ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิโดยการให้คอมพิวเตอร์ควบคุมและ อ่านอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง -50°C

```

Program Liquid_Nitrogen_Temperature_Controller;
uses crt;                                คำสั่งใช้จอ
var ch      : char;                       คำสั่งกำหนดตัวแปร
    i, j, x, DV : integer;
    AV, T, Ts  : real;
type AR_data = array[1..4] of byte;      คำสั่งกำหนดรูปแบบของข้อมูล
const                                               คำสั่งกำหนดค่าคงที่
    PA1      = $0300; กำหนด address ของพอร์ท A ของ IC 8255
    PA2      = $0304; กำหนด address ของพอร์ท A ของ IC 8255
    Pcontrol1 = $0303; กำหนด address ของพอร์ทควบคุม ของ IC 8255
    Pcontrol2 = $0307; กำหนด address ของพอร์ทควบคุม ของ IC 8255
    Data1_out : AR_data = ($88, $44, $22, $11); ค่าแรงดันไฟฟ้าส่งรับให้มอเตอร์หมุน
                                                ในทิศทางหนึ่ง
    Data2_out : AR_data = ($11, $22, $44, $88); ค่าแรงดันไฟฟ้าสำหรับให้มอเตอร์หมุน
                                                ในอีกทิศทางหนึ่ง

begin
    clrscr;                                คำสั่งล้างจอภาพ
    port[Pcontrol1]:= $80; กำหนด control word สำหรับให้พอร์ท A/B เป็นพอร์ทอินพุท/เอาท์พุท
    port[Pcontrol2]:= $90; กำหนด control word สำหรับให้พอร์ท A/B เป็นพอร์ทอินพุท/เอาท์พุท
    Ts := 0;
    gotoxy(25,4); writeln(' MEASURE AND CONTROL AT LIQUID N2 REGION ');
    gotoxy(14,2); writeln('.....');
    gotoxy(25,4); writeln('Setting Temperature = ',Ts:3:0);          แสดงอุณหภูมิที่ตั้ง
    gotoxy(50,4); writeln('C');
    gotoxy(47,4); readln(Ts);                                         ตั้งค่าอุณหภูมิทำงาน

    repeat
        gotoxy(36,12); writeln('START');
        for i:= 1 to 4 do      ให้สแตปกับมอเตอร์หมุน
            begin

```

```

    sound(1000);delay(10);nosound;
    port[PA1]:=data1_out[i];
    delay(400);

end;

gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
DV:=port[PA2];          รับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารซึ่งเป็นหัววัดอุณหภูมิ
gotoxy(35,17); writeln('Digital Voltage =', DV := 3);
AV := (5/255)*DV;       สั่งให้แปลงแรงดันดิจิทัลเป็นแรงดันอนาลอก
gotoxy(34,18); writeln('Analog Voltage =', AV:3:2,'V');
T := -1.6*AV*AV-7.8343*AV+23.015;   สั่งให้แปลงแรงดันอนาลอกเป็นอุณหภูมิ
gotoxy(34,22); writeln('Measure Temperature =', T:3:2);   อ่านอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า
gotoxy(43,22); writeln('C');
delay(100);           สั่งให้หน่วงเวลา
sound(5000);delay(10);nosound;

until T<Ts;          ทำซ้ำจนอุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้
for j := 1 to 1500 do
begin
repeat
    gotoxy(36,12); writeln('START');
    for i:= 1 to 4 do          ให้สลับบิตของเคอร์เรนท
    begin
        sound(3000);delay(10);nosound;
        port[PA1]:=data1_out[i];
        delay(500);

    end;
    gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
    DV:=port[PA2];          รับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารซึ่งเป็นหัววัดอุณหภูมิ
    gotoxy(35,17); writeln('Digital Voltage =', DV := 3);
    AV := (5/255)*DV;       สั่งให้แปลงแรงดันดิจิทัลเป็นแรงดันอนาลอก
    gotoxy(34,18); writeln('Analog Voltage =', AV:3:2,'V');
    T := -1.6*AV*AV-7.8343*AV+23.015;   สั่งให้แปลงแรงดันอนาลอกเป็นอุณหภูมิ
    gotoxy(34,22); writeln('Measure Temperature =', T:3:2);   อ่านอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า
    gotoxy(43,22); writeln('C');

```

```

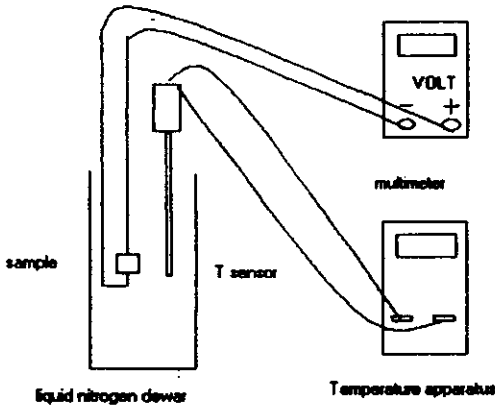
delay(100);          สั่งให้หน่วงเวลา
sound(7000);delay(10);nosound;
until T<Ts;          ทำซ้ำจนอุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้
repeat
gotoxy(36,12); writeln('START');
for i:= 1 to 4 do    ให้สแตปปีงมอเตอร์หมุน
begin
    sound(9000);delay(10);nosound;
    port[PA1]:=data2_out[i];
    delay(500);
end;
gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
DV:=port[PA2];      รับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารซึ่งเป็นหัวใจอุณหภูมิ
gotoxy(35,17); writeln('Digital Voltage =', DV:=3);
AV := (5/255)*DV;   สั่งให้แปลงแรงดันดิจิทัลเป็นแรงดันอนาลอก
gotoxy(34,18); writeln('Analog Voltage =', AV:3:2,'V');
T :=-1.6*AV*AV-7.8343*AV+23.015;   สั่งให้แปลงแรงดันอนาลอกเป็นอุณหภูมิ
gotoxy(34,22); writeln('Measure Temperature =', T:3:2); อ่านอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า
gotoxy(43,22); writeln('C');
delay(100);        สั่งให้หน่วงเวลา
sound(5000);delay(10);nosound;
until T>Ts-1;      ทำซ้ำจนอุณหภูมิมักกว่าอุณหภูมิตั้งไว้
end;
gotoxy(37,24); writeln('END');
delay(9000);       สั่งให้หน่วงเวลา
end.

```

2.5.8 การประยุกต์ของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ให้ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ความเย็น

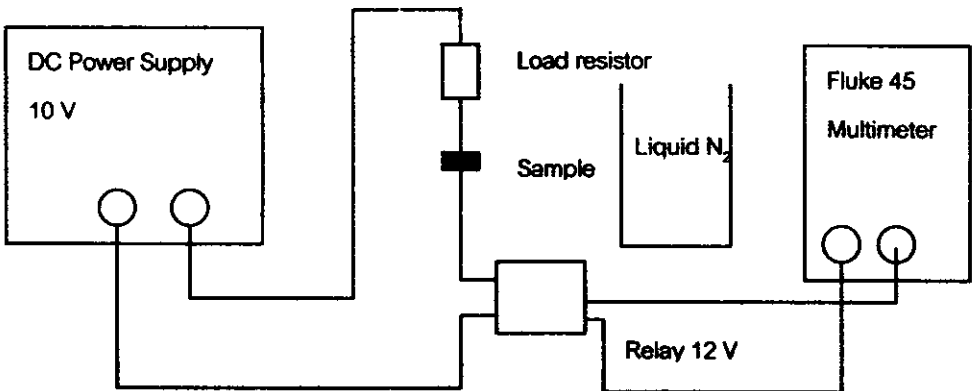
ก่อนที่จะทำการประยุกต์ของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ให้ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ความเย็น ได้จับชุดทดลองสำหรับวัดความต้านทานที่ขึ้นกับอุณหภูมิในช่วง 23 ถึง 135 °C เท็มอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า ใช้มัลติมิเตอร์ (Fluke 45 Dual Display Multimeter) วัดความต้านทานไฟฟ้าของสารที่เตรียมได้และใช้วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ (AVD M890C[®]) วัดอุณหภูมิ นำผลใส่ในตาราง ทลอดกราฟและแสดงสมการด้วย EXCEL (ได้วัดของเทอร์มิสเตอร์ที่นำมาเพื่อไปเปรียบเทียบด้วย) คำนวนค่า α ของเทอร์มิสเตอร์ที่เตรียมได้กับเทอร์มิสเตอร์ที่ไว้ในทาง

การค้ำ ส่วนการวัดความต้านทานที่ขึ้นกับอุณหภูมิในช่วง -133 ถึง 23 °ซ มีการทดลองในทำนองเดียวกัน แต่เปลี่ยนเตาไฟฟ้าเป็นไนโตรเจนเหลว (รูปที่ 2.5.7)



รูปที่ 2.5.7 การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับอุณหภูมิในช่วง -133 ถึง 23 °ซ

การทดสอบเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสวิตช์ความเย็นทำได้โดยการจัดเครื่องมือตามรูปที่ 2.5.8 ป้อนแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานโหลด 200 โอห์ม สารที่เตรียมได้และขดลวดทองรีเลย์ ทำการจุ่มสารลงในไนโตรเจนเหลว สังเกตผลที่เกิดขึ้นโดยการฟังเสียงของรีเลย์ ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของสวิตช์รั้ว 3 กับ 5 ของทองรีเลย์เพื่อดูการเปิดปิดสวิตช์ในขณะที่สารได้รับอุณหภูมิของไนโตรเจนเหลว



รูปที่ 2.5.8 การทดสอบสารที่เตรียมได้ให้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ความเย็น

2.6 การทดสอบเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC

2.6.1 การวัดความต้านทานที่ขึ้นกับอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC

ทดสอบปรากฏการณ์ PTC ทำได้โดยการวัด R vs T ในช่วงอุณหภูมิที่เกิดปรากฏการณ์นี้ เขียนกราฟแล้ว หาสมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นบวกหรือค่าความไวของเทอร์มิสเตอร์และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากเส้นกราฟ

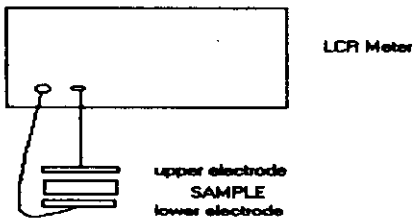
2.6.2 การทดสอบของเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดอุณหภูมิ

ทดสอบเป็นหัววัดอุณหภูมิโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่ที่รีทำได้โดยให้แผงวงจรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในทางการค้าเป็นตัวเปรียบเทียบ การทดลองจะจัดเครื่องมือทำนองเดียวกันกับการทดสอบของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC ให้ทำหน้าที่เป็นหัววัดอุณหภูมิ (ดูหัวข้อ 2.5.4)

2.7 การทดสอบตัวเก็บประจุไฟฟ้า

2.7.1 การวัดสมบัติไดอิเล็กตริกในสนามไฟฟ้าตรงและในสนามไฟฟ้าสลับ

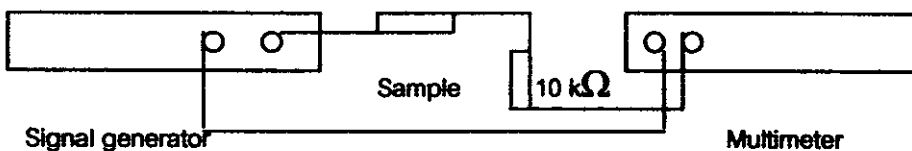
วัดสมบัติไดอิเล็กตริกในสนามไฟฟ้าตรงทำได้โดยการวัดความจุไฟฟ้าแล้วคำนวณค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและสภาพอ่อนไหวทางไฟฟ้า ส่วนในสนามไฟฟ้าสลับปริมาณที่จะวัดได้แก่ $Z, G, C, D, Q, \epsilon_r$ และ χ_e ใช้มิเตอร์ LCR (HP 4263B) ดังรูปที่ 2.7.1 วัด Z, G, C, D, Q vs f ที่อุณหภูมิห้อง (24°C) ของสารที่มีความหนา 3.26 mm และเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.93 mm เมื่อ Z เป็นอิมพีแดนซ์ (impedance) G เป็นความนำไฟฟ้า (conductance) C เป็นความจุไฟฟ้า (capacitance) D เป็นตัวประกอบการสูญเสีย (dissipation factor) Q เป็นตัวประกอบคุณภาพ (quality factor) และ f เป็นความถี่ของแรงดันไฟฟ้า ความถี่ที่ใช้วัดมี 5 ค่า คือ 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz และ 100 kHz และแรงดันไฟฟ้าของเครื่องที่ส่งไปยังสาร 1000 mV พล็อตกราฟและหาสมการ



รูปที่ 2.7.1 การวัด Z, G, C, D, Q vs f ด้วย LCR Meter

2.7.2 การทดสอบทดสอบอุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน (high pass filter)

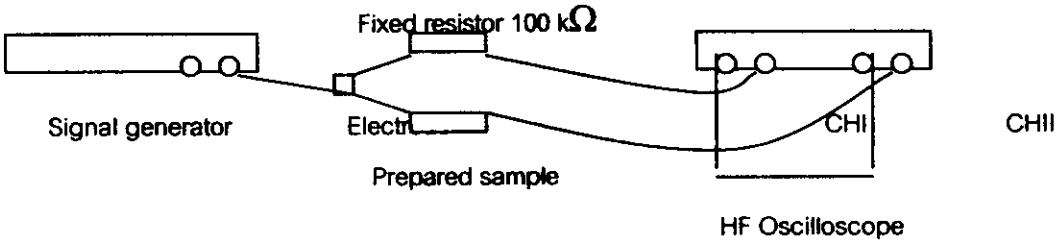
จัดชุดการทดลองแสดงดังแสดงในรูปที่ 2.7.2 ปลั๊กกระแสไฟฟ้าจากกรีกแนลเยเนอเรเตอร์ (5 MHz Function Generator) ไหลผ่านสารและตัวต้านทาน $10\text{ k}\Omega$ ใช้มัลติมิเตอร์ (Fluke 45 Dual Display Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าสลับตกคร่อมสาร (V) ที่ความถี่ (f) ในช่วง 5 kHz ถึง 400 kHz ที่อุณหภูมิห้อง (24°C) บันทึกผลลงในตาราง พล็อตกราฟ V vs f และหาสมการ



รูปที่ 2.7.2 การทดสอบทดสอบอุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน

2.7.3 การทดสอบการเลื่อนเฟสของสาร

จัดชุดทดลองตามรูปที่ 2.7.3 ปลั๊กกระแสไฟฟ้าจากกริกแนลเยเนอเรเตอร์ (5 MHz Function Generator) มาชั่วคราวที่แรงดันไฟฟ้าถูกส่งต่อผ่านตัวต้านทานค่าคงที่ 100 kΩ ไปยัง CHI และผ่านตัวต้านทานค่าคงที่ 100 kΩ และสารที่เตรียมได้ไปยัง CHII ของออสซิลโลสโคปความถี่สูง (Tektronic : TDS 420A) เปรียบเทียบตำแหน่งเฟสของแรงดันไฟฟ้า สังเกตภาพออกทางเครื่องพิมพ์ (Epson RX-80)

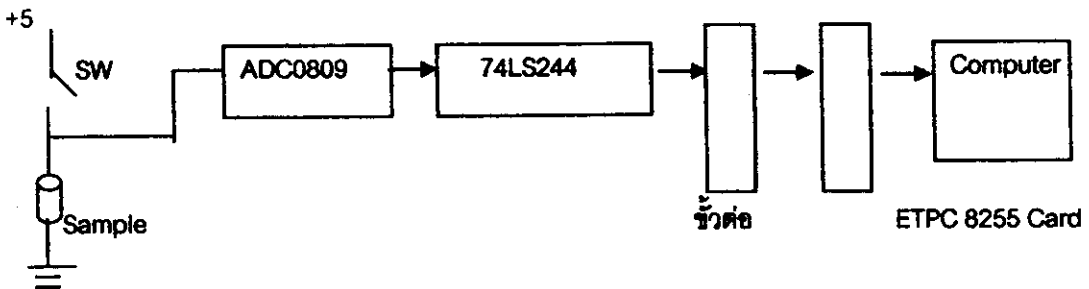


รูปที่ 2.7.3 การทดสอบการเลื่อนเฟสของสาร

2.7.4 การทดสอบการเก็บประจุและคายประจุไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

การทดสอบการเก็บประจุและคายประจุไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ทำได้ดังนี้

- 1) สร้างแผงวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ดังรูปที่ 2.7.4 เขียนโปรแกรมภาษาเทอร์โบปาสคาลเพื่อควบคุมการอ่านแรงดันไฟฟ้า พร้อมทั้งทดสอบจนใช้งานได้
- 2) ทำการปรับเทียบเครื่องมือโดยจ่ายแรงดันตกคร่อมสารที่เตรียมได้ซึ่งจะต้องถูกทดสอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุ สัญญาณตอบสนองจะถูกป้อนเข้าที่ไอซี ADC0809 ซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงดันอนาลอกให้เป็นแรงดันดิจิทัล ไอซี 74LS244 จะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสารซึ่งเป็นแรงดันอนาลอกจะเคลื่อนที่ผ่าน ET-PC8255 Card ผ่านสล็อตไปยังแรม ใช้คำสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสาร (แรงดันอนาลอก) บนจอ

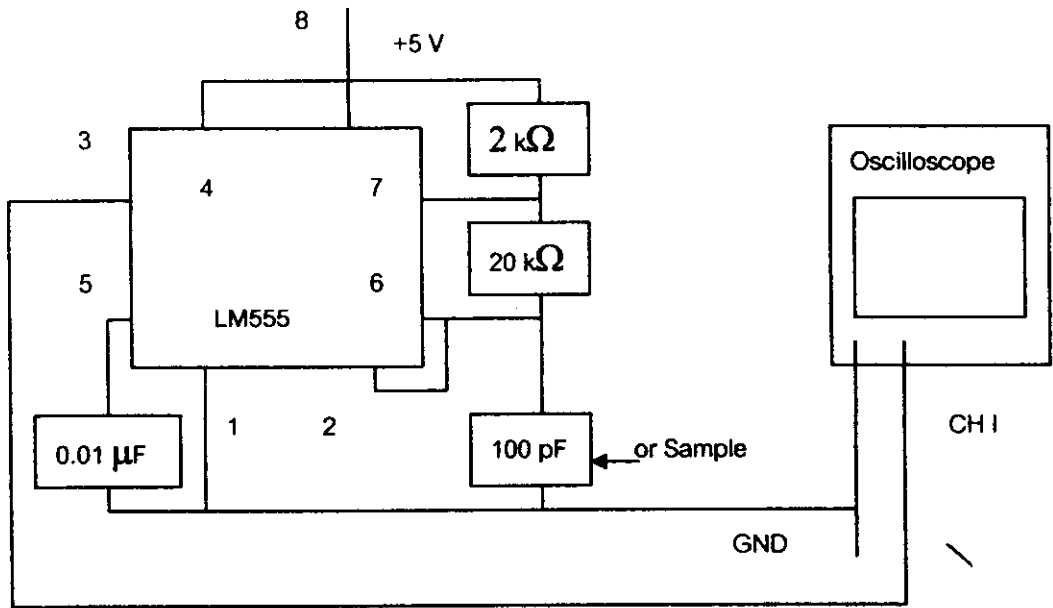


รูปที่ 2.7.4 แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับให้คอมพิวเตอร์

แสดงการเก็บและคายประจุไฟฟ้า

2.7.5 การนำตัวเก็บประจุไฟฟ้าไปไว้ในวงจรออสซิลเลเตอร์

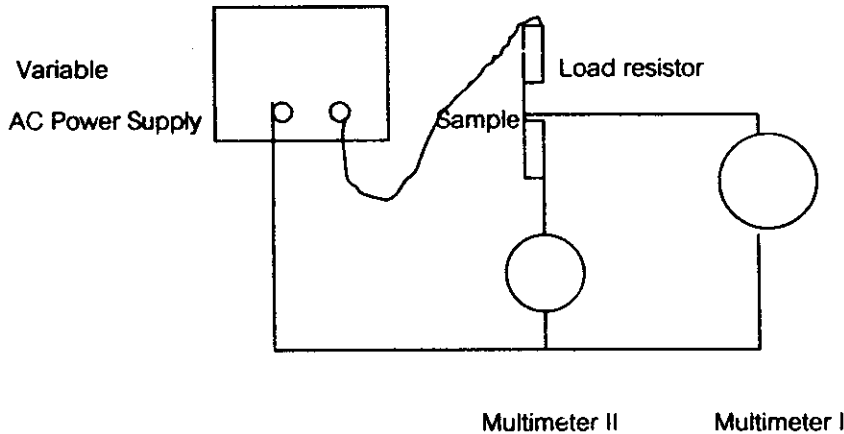
นำสารที่เตรียมได้ใช้งานเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าในวงจรออสซิลเลเตอร์ทำได้โดยนำสารที่เตรียมติดตั้งแทนที่ตำแหน่งของตัวเก็บประจุเชิงการคำนวณในวงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ IC555 ดังรูปที่ 2.7.5 แสดงภาพของแรงดันไฟฟ้าด้วยออสซิลโลสโคป ส่งพิมพ์ภาพหรือนำข้อมูลไปแสดงภาพด้วย EXCEL



รูปที่ 2.7.5 การนำตัวเก็บประจุไฟฟ้าไปไว้ในวงจรออสซิลเลเตอร์

2.7.6 การทดสอบสมบัติวาริสเตอร์ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า

การจัดชุดการทดลองแสดงดังรูปที่ 2.7.6 เปิดสวิตช์ แรงดันไฟฟ้าบ้าน 220 V จะมาเข้าแบริแอก แรงดันไฟฟ้าจากแบริแอกถูกส่งต่อไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า 220 V-1300 V แรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าจะมายังสารที่เตรียม เพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดยการปรับแบริแอก ใช้มัลติมิเตอร์ I (Fluke 45 Dual Display Multimeter) วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสาร (V) ใช้มัลติมิเตอร์ II (AVD M890C) วัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสาร (I) บันทึกค่า V และ I แล้วทำการพลอตกราฟ หาแรงดันเบรคดาวน์ (BV) จำนวนสนามเบรคดาวน์ (BE) และหาสัมประสิทธิ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น (α) หลังจากนั้นได้นำสมบัติเชิงฟิสิกส์ที่วัดได้จากสารตัวอย่างที่เตรียมจากสาร $ZnO+0.01Sb_2O_3$ เทียบกับค่าที่วัดได้จากวาริสเตอร์ที่ใช้ในเชิงการค้ารหัส 14K471U (Table I) เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าผลข้อมูลจะชี้ว่าสารที่เตรียมขึ้นมามีคุณสมบัติของวาริสเตอร์



รูปที่ 2.7.6 การทดสอบสมบัติวาริสเตอร์ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า

2.7.7 การทดสอบสมบัติความจุ-แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้า

เปิดเครื่อง 4140 μ PA Meter / DC Voltage Source ไปที่ตำแหน่ง ON เลือกปุ่ม C-V เลือก V_A ตั้ง

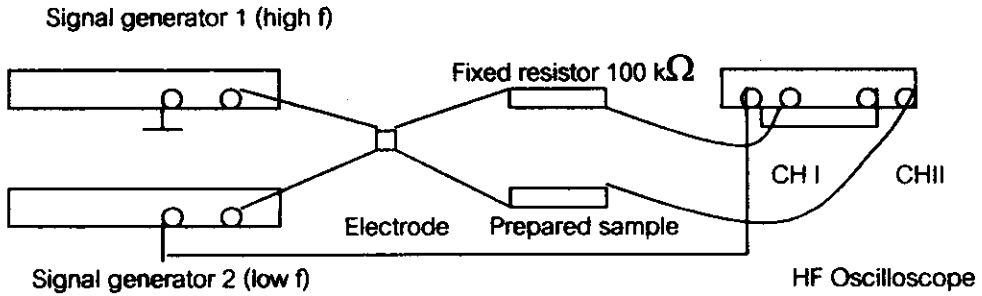
Parameter ดังนี้ Start V = 2.2 V , Stop V = 10 V และ Step V = 0.2 V, $dv/dt \geq 0.1$ V/s, Step delay time = 5 s

ทดลองเฉพาะสารที่ 1 $BaTiO_3 + 0.05Nb_2O_5$ เนื่องจากสารสูตรนี้มีความจุต่ำ เครื่องสามารถวัดค่าได้ ส่วนสารสูตรอื่นมีความจุสูง เครื่องแสดงโหลดเกิน (over load) วัดไม่ได้ บันทึกค่า C และ V เขียนกราฟ C vs V ของสาร

2.7.8 การทดสอบการแยกแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำออกจากแรงดันไฟฟ้าความถี่ผสมระหว่างความถี่ต่ำกับความถี่สูง

จัดชุดทดลองตามรูปที่ 2.7.8 ปลดอยแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงจากจิกแนลเยเนอเรเตอร์ 1 (5 MHz

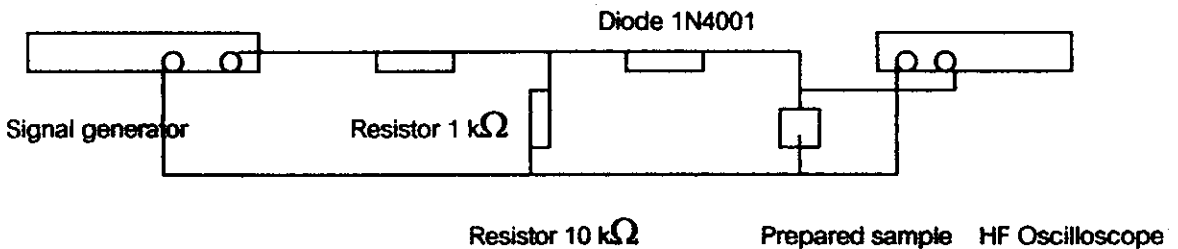
Function generator) และ แรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำจากจิกแนลเยเนอเรเตอร์ 2 มายังขั้วไฟฟ้า(Electrode) แรงดันไฟฟ้าทั้ง 2 ค่า จะรวมกันโดยเฉพาะทางด้านความถี่ นำแรงดันไฟฟ้าที่ผสมกันนี้ผ่านตัวต้านทานค่าคงที่ $100\text{ k}\Omega$ ไปยัง CHI และสารที่เตรียมได้(prepared sample)ไปยัง CHII ของออสซิลโลสโคปความถี่สูง (Tektronic : TDS 420A) แล้วพิจารณาดูว่าความถี่ต่ำกับสูงผ่านไปทางเส้นทางใดดีกว่า สังพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ (Epson RX-80)



รูปที่ 2.7.8 การทดสอบการแยกแรงดันไฟฟ้าความถี่ต่ำออกจากแรงดันไฟฟ้าความถี่สมระหว่างความถี่ต่ำกับความถี่สูง

2.7.9 การทดสอบเป็นตัวเก็บประจุความถี่สูง

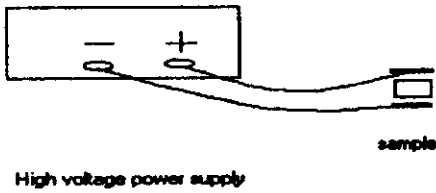
จัดชุดการทดลองแสดงดังแสดงในรูปที่ 2.7.9 ปลั๊กกระแสไฟฟ้าจากจิกแนลเลนเนอร์เตอร์(5 MHz Function Generator)ไหลผ่านตัวต้านทาน $1\text{ k}\Omega$ และ $10\text{ k}\Omega$ ไดโอด (1N4001)ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าสลับเป็นแรงดันไฟฟ้าตรง สารที่เตรียมได้ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าทำหน้าที่กรองแรงดันไฟฟ้าให้เรียบ ใช้ออสซิลโลสโคป (Tektronic : TDS 420A) วัดและแสดงภาพของแรงดันไฟฟ้า ส่งพิมพ์ภาพออกทางเครื่องพิมพ์ (Epson RX-80)



รูปที่ 2.7.9 การทดสอบเป็นตัวเก็บประจุความถี่สูง

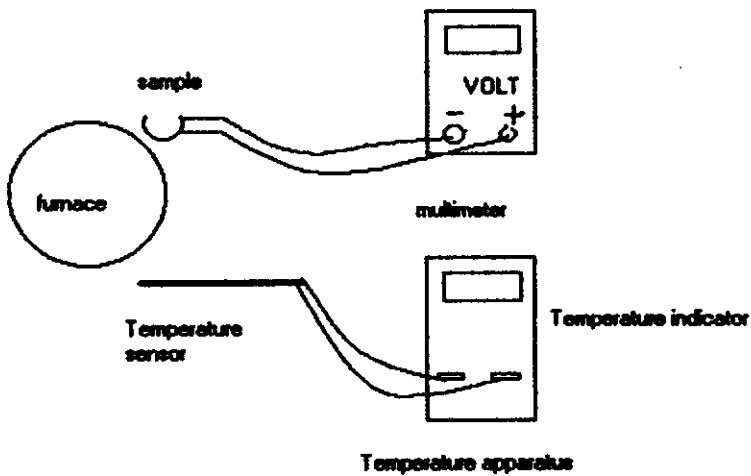
2.7.10 การทดสอบผลของสนามไฟฟ้าแรงสูงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสมบัติของตัวเก็บประจุ

โพลิงสารโดยใช้แรงดันไฟฟ้า $10,000\text{ V}$ เป็นเวลา 113 min ที่อุณหภูมิห้อง ดังแสดงในรูปที่ 2.7.10 (ก)



รูปที่ 2.7.10 (ก) แสดงการโหล่งสาร

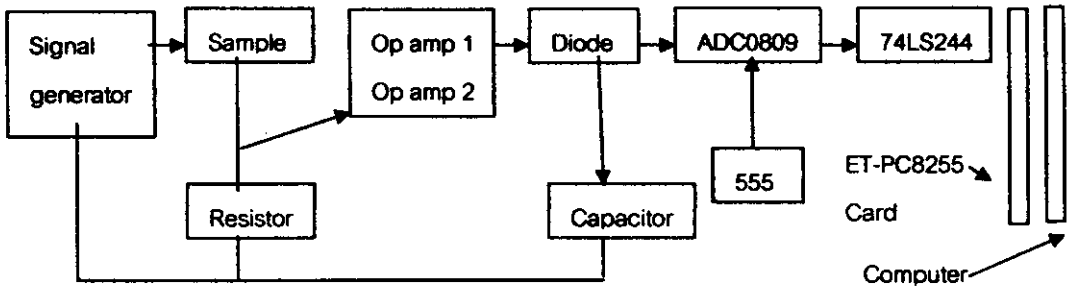
ทดสอบผลของสนามไฟฟ้าแรงสูงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสมบัติของสารจาก PTC ไปเป็น NTC ทำได้โดย
 จัดชุดทดลองดังแสดงในรูปที่ 2.7.10 (ข) แล้ววัดความต้านทานไฟฟ้า (R) ที่ขึ้นกับอุณหภูมิ (T) ก่อนโหล่งและหลังโหล่ง
 ด้วยเครื่องมือมัลติมิเตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิ



รูปที่ 2.7.10 (ข) แสดงการทดสอบ PTC effect ก่อนโหล่ง และ NTC Effect หลังโหล่ง

2.7.11 การทดสอบการแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเป็นความถี่

ประกอบอุปกรณ์ลงบนโปรโตบอร์ดโดยอาศัยวงจรเชื่อมต่อที่ได้เตรียมไว้ดังรูปที่ 2.7.11 หลังจากนั้นก็ป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในวงจร ตรวจสอบใช้งานได้ ถ้าวงจรใช้ได้ เมื่อเราปรับที่ VR 10 k Ω การติดดับของ LED จะเปลี่ยนไปมา เขียนโปรแกรมเอาท์พุทด้วยภาษาเทอร์โบปาสคาล เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าออกทางพอร์ท B เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าวงจรที่ต่อขึ้นใช้งานได้ สังเกตจากได้จากการติดดับของ LED ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากคอมพิวเตอร์เป็น 5 V LED จะติด แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากคอมพิวเตอร์เป็น 0 V LED จะดับ การนำแรงดันไฟฟ้าออกนอกคอมพิวเตอร์จะใช้คำสั่ง Port[PB]:=0 สำหรับ 0 V และ Port[PB]:=255 สำหรับ 5 V เขียนโปรแกรมอินพุทด้วยภาษาเทอร์โบปาสคาล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านหรือรับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ด้วย VR 10 k Ω ถูกป้อนเข้าทางขา 26 (I₀) ของ ADC0809 แรงดันไฟฟ้าที่นี้เรียกว่า แรงดันอนาลอก ADC0809 จะทำหน้าที่แปลงแรงดันอนาลอก (AV) เป็นแรงดันดิจิทัล (DV) วงจร IC555 จะทำหน้าที่ผลิตแรงดันรูปสี่เหลี่ยมแล้วส่งเข้าขา 10 ของ ADC0809 เพื่อให้ IC ตัวนี้ ทำงาน แรงดันดิจิทัลขนาด 8 บิต ถูกส่งผ่าน 74LS244 ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ (buffer) ใช้ LED 8 ตัว อ่านหรือแสดงแรงดันดิจิทัลที่เอาท์พุท ของ 74LS244 แรงดันดิจิทัล 8 บิต ซึ่งก็คือ D7,D6,D5,D4,D2,D1,D0 นี้จะถูกส่งผ่าน ET-PC8255 Card โดยผ่านทางพอร์ท A ของ IC8255 แล้วถูกส่งต่อเข้าไปในแรม (RAM) การนำแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเชื่อมต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะใช้คำสั่ง DV:=Port[PA] ใช้คำสั่ง writeln(' ') ให้เครื่องแสดงค่าของ DV, AV หรือ f บนจอ ทำการปรับเทียบค่า (calibrate) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อ่านความถี่โดยใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัวใจซึ่งทำได้โดยเริ่มจากป้อนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปในวงจรที่ประกอบด้วยสารที่เตรียมได้ซึ่งต่ออนุกรมกับความต้านทาน x k Ω และขยายแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความถี่ แปลงเป็นไฟฟ้าตรงด้วยไดโอดแล้วป้อนเข้าขา 26 (I₀) ของ ADC0809 เพื่อแปลง AV เป็น DV ส่งผ่าน 74LS244 และ ET-PC8255 Card เข้าไปใน RAM สั่งให้แสดงค่า DV บนจอ แปลง DV เป็น AV ด้วยคำสั่ง AV:=(5/255)*DV สั่งให้แสดงค่า AV บนจอ เพิ่มความถี่ของเครื่องกำเนิดสัญญาณโดยการอ่านความถี่จากเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า (true) และแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสาร (AV) บนจอคอมพิวเตอร์ในช่วงความถี่หนึ่ง นำค่า AV กับ true ไปเขียนกราฟและแสดงสมการ true = fn(AV) ด้วย EXCEL เขียนสมการความสัมพันธ์ของ true vs AV ลงในโปรแกรมควบคุมการวัด หลังจากนั้นก็สั่งให้โปรแกรม ทำงานแล้วอ่านความถี่จากเครื่องจริง (true) กับความถี่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัวใจ (fmeasure) นำค่าทั้งสองไปเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบค่า เมื่อดึงขึ้นตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นการปรับเทียบค่า เราจะได้เครื่องวัดความถี่ที่แสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์และใช้สารที่เตรียมได้เป็นหัวใจ



รูปที่ 2.7.11 บล็อกไดอะแกรมของวงจรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อ่านความถี่ของแรงดันไฟฟ้าโดยให้สารที่เตรียมได้ (สารที่ 3, 4, 5 และ 6) เป็นหัววัด

โปรแกรมที่ให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อ่านความถี่ของแรงดันไฟฟ้าโดยให้สารที่เตรียมได้เป็นหัววัด

Program Frequency_Sensor_Testing;

uses crt;

var i, j, x, y, DV : integer;

AV, f : real;

const PA = \$0304;

Pcontrol = \$0307;

begin

clrscr;

port[Pcontrol] := \$90;

gotoxy(23,2); writeln("FREQUENCY
MEASUREMENT");

gotoxy(23,3); writeln('-----');

DV:=0; AV:=0; f:=0;

for i := 1 to 100 do

begin

for j := 1 to 255 do

begin

DV := port[PA];

AV := (5/255)*DV;

gotoxy(26,14); writeln('Analog Voltage (AV) = 'AV:3:3, ' V');

delay(1)

f := (?*AV*AV) - (?*AV) + ?;

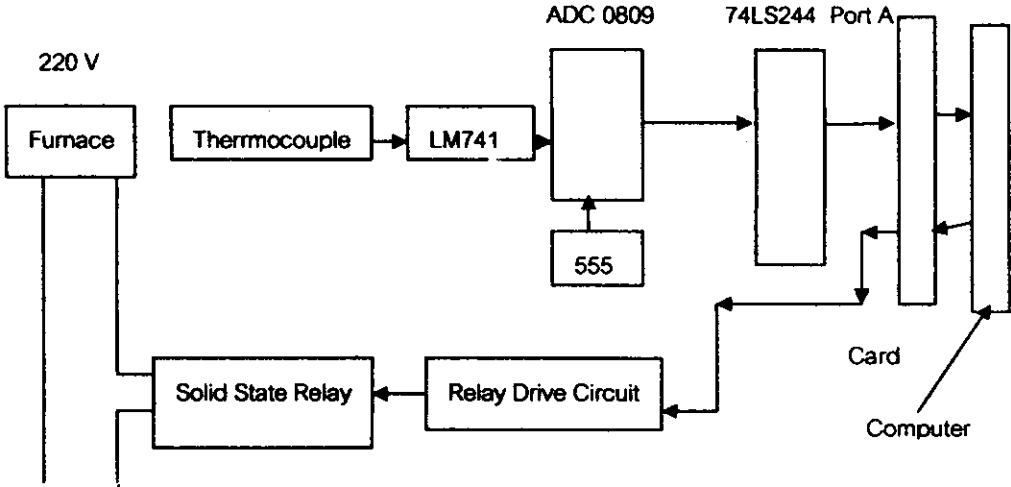
```

gotoxy(20,20);
writeln('*****')
gotoxy(17,22); writeln('Measure Frequency = ',f:3:2, ' C');
delay(1);
gotoxy(15,24);
writeln('>>>*****<<<');
delay(500);
end;
end;
end.

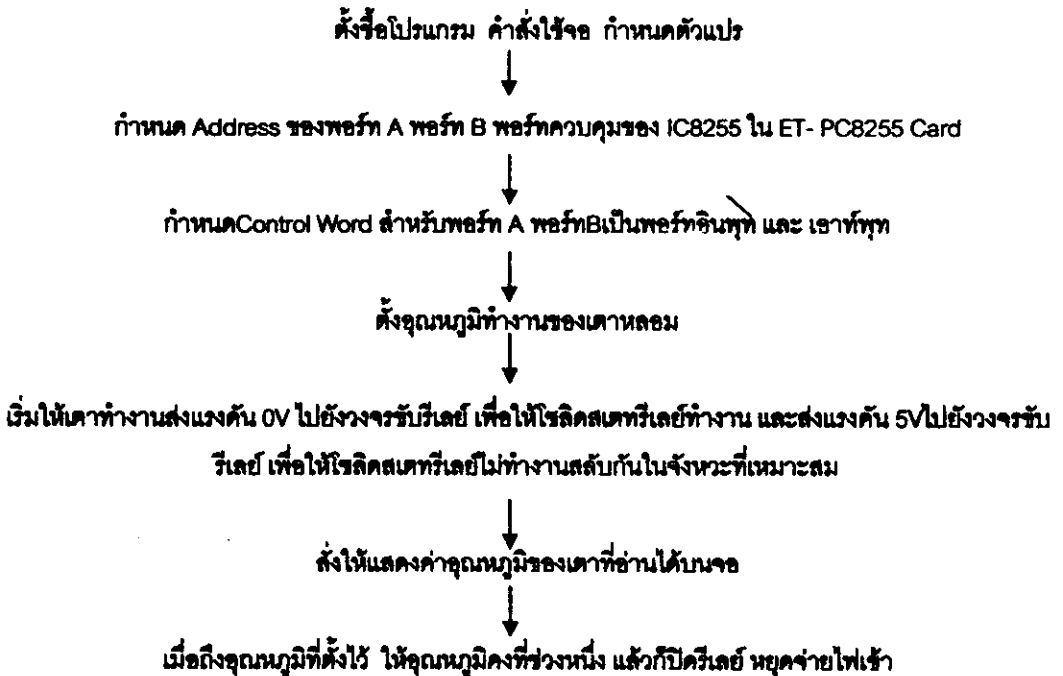
```

2.8 การจัดเตรียมเตาหลอม

- 1) จัดชุดการทดลองตามรูปที่ 2.8.1 เพื่อให้คอมพิวเตอร์ควบคุมวงจรรับรีเลย์เพื่อให้สวิตช์ 3-4 เปิดและปิดสลับกัน ให้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของรีเลย์เพื่อให้ไฟบ้าน 220V เข้าและหยุดเข้าเตาหลอม
- 2) ให้คอมพิวเตอร์อ่านอุณหภูมิภายในผ่านเตาหลอม (รูปที่ 2.8.1) เทอร์โมคอปเปิล (thermocouple) จะแปลงอุณหภูมิให้เป็นแรงดันเทอร์โมอิเล็กทริก (V) เครื่องอ่านอุณหภูมิจะแสดงอุณหภูมิ แต่เนื่องจากแรงดันไฟฟ้า (Vdc) ที่ออกมาจากเทอร์โมคอปเปิลเป็นมิลลิโวลต์ แรงดันมีค่าต่ำ จะไม่สามารถป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ได้ต้องใช้ออปแอมป์เป็นตัวขยายแรงดันนี้เรขาค 3 ของออปแอมป์ (LM741) ขยายส่งออกขา 6 ส่งเข้าขา 2 ของออปแอมป์ตัวที่ 2 ขยายส่งออกขา 6 ป้อนเข้า ADPC 0809 แปลงแรงดัน AV เป็น DV ส่งผ่านบัฟเฟอร์ (buffer) 74LS244 ผ่าน ET- PC8255 Card เข้าคอมพิวเตอร์
- 3) เขียนโปรแกรมสำหรับระบบการจ่ายไฟฟ้า วัดและควบคุมอุณหภูมิของเตาอบไฟฟ้า หลักการทำงานของระบบเป็นไปตามขั้นตอนตามรูปที่ 2.8.2 แล้วเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาเทอร์โมปาลาสคาลให้ทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้ารีเลย์ของเตาไฟฟ้า ตั้งและอ่านอุณหภูมิภายในห้องเตาหลอม ตัดแรงดันไฟฟ้าเข้ารีเลย์ของเตาหลอมเมื่ออุณหภูมิของเตาถึงค่าที่ตั้งไว้หลังจากนั้นก็ให้เตามีอุณหภูมิคงที่
- 4) บันทึกค่าอุณหภูมิของเตาที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และเครื่องอ่านอุณหภูมิ



รูปที่ 2.8.1 โครงสร้างระบบการจ่ายไฟฟ้า วัดและควบคุมอุณหภูมิของเตาหลอมไฟฟ้า



รูปที่ 2.8.2 แสดงโปรแกรมที่แสดงการจ่ายแรงดันไฟฟ้า วัดและควบคุมอุณหภูมิของเตาหลอมไฟฟ้า

```
Program Furnace_Temperature_Controller;
```

```
uses crt, graph;
```

```
var
```

```
  ch                : char;
```

```
  i, j, DV          : integer;
```

```
  AV, I, Is         : real;
```

```
Const PA           = $0304;
```

```
      PB           = $0305;
```

```
      Pcontrol     = $0307;
```

```
begin
```

```
  port[Pcontrol]:= $90;
```

```
  clrscr;
```

```
  gotoxy(14,1); writeln('FURNACE TEMPERATURE CONTROLLER (25-1200 C) FOR MATERIALS');
```

```
  gotoxy(14,2); writeln('-----');
```

```
  gotoxy(25,4); writeln('Setting Temperature = ',Ts:3:0');
```

```
  gotoxy(50,4); writeln(' C ');
```

```
  gotoxy(47,4); readln('Ts');
```

```
  repeat
```

```
    gotoxy(33,12); writeln('FURNACE START');
```

```
    port[PB]:=255;
```

```
    delay(round(35*((6/100000)*T*T-0.0173*T+6.8207)));
```

```
    sound(900); delay(10); nosound;
```

```
    gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
```

```
    DV:= port[PA];
```

```
    gotoxy(34,17);n writeln('DV = ',DV:3');
```

```
    AV:= (5/255)*DV;
```

```
    gotoxy(34,18); writeln('AV = ',AV:1:3, ' V ');
```

```
    I:=314.32*AV+88.864;
```

```
    gotoxy(34,22); writeln('T = ',T:3:3');
```

```
    gotoxy(43,22); writeln(' C ');
```

```
    port[PB]:=0;
```

```
    delay(600);
```

```
    sound(9000); delay(10); nosound;
```

```

until T>Ts;
for l:= 1 to 1500 do
  begin
  repeat
    gotoxy(33,12); writeln('FURNACE START');
    port[PB]:=0;
    sound(900); delay(10); nosound;
    gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
    DV:= port[PA];
    gotoxy(34,17);n writeln('DV = ',DV:3');
    AV:= (5/255)*DV;
    gotoxy(34,18); writeln('AV = ',AV:1:3,' V ');
    T:=314.32*AV+88.864;
    gotoxy(34,22); writeln('T = ',T:3:3');
    gotoxy(43,22); writeln(' C ');
    port[PB]:=0;
    delay(200);
    sound(9000); delay(10); nosound;
  until T>Ts-1;
repeat
  port[PB]:=255;
  sound(5000); delay(90); nosound;
  gotoxy(29,15); writeln('Reading Temperature');
  DV:= port[PA];
  gotoxy(34,17);n writeln('DV = ',DV:3');
  AV:= (5/255)*DV;
  gotoxy(34,18); writeln('AV = ',AV:1:3,' V ');
  T:=314.32*AV+88.864;
  gotoxy(34,22); writeln('T = ',T:3:3');
  gotoxy(43,22); writeln(' C ');
  delay(200);
until T>Ts;

```

```
begin
  gotoxy(37,23); writein('Furnace OFF');
  gotoxy(39,24); writein('END');
  delay(5000);
end;
end.
```